

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN

CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES (EMPRESAS E INSTITUCIONES DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS)

APLICACION Y DESARROLLO DE LAS
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS DE CALIDAD EN
UNA PLANTA ENVASADORA DE CIANOCRILATOS
Y PLASTILINAS EPOXICAS

TRABAJO DE SEMINARIO

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO QUÍMICO

presenta juan barajas mendez

ASESOR: ING. JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ZAMUDIO

Cuautitlan izcalli, edo. de mex.

2000

237213





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN UNIDAD DE LA ADMINISTRACION ESCOLAR DEPARTAMENTO DE EXAMENES PROFESIONALES



nas Epoxicas.

DR. JUAN ANTONIO MONTARAZ CRESPO DIRECTOR DE LA FES CUAUTITLAN PRESENTE

ATN: Q. Ma. del Carmen García Mijares Jefe del Departamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán

Con base en el art. 51 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES-Cuautitlán, nos permitimos comunicar a usted que revisamos el Trabajo de Seminario: Calidad en las Organizaciones (Empresas e Instituciones de Producción y de Servicios). Aplicación y Desarrollo de las Herramientas Estadis ticas de Calidad en una planta envasadora de Cianocrilatos y Plastili

con número de cuenta: 8352007-5 para obtener el título de : Ingeniero Químico

Considerando que dicho trabajo reúne los requisitos necesarios para ser discutido en el EXÁMEN PROFESIONAL correspondiente, otorgamos nuestro VISTO BUENO.

ATENTAMENTE "POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Cuautitlán Izcalli, Méx. a 21 de agosto de 2000 FIRMA PROFESOR MODULO

I Y III Ing. Juan de la Cruz Hernández Zamudio Ing. Juan Rafael Garibav Bermúdez Dr. Armando Aguilar Márquez IV

que presenta el pasante: <u>Juan Barajas Méndez</u>

DEDICATORIA

A DIOS:

Por darme la existencia y poder ser parte de este mundo.

A MIS PADRES:

Con respeto y agradecimiento.

Abel Barajas García María del Refugio Méndez Gómez

Quienes con su esfuerzo, apoyo y confianza, Me han permitido lograr uno de mis más grandes Objetivos, la culminación de mi carrera profesional.

A MI ESPOSA:

Tomy

Como agradecimiento por su amor, cariño, Comprensión y apoyo incondicional que Siempre me ha brindado en los momentos Más difíciles.

Gracias.

INDICE

OBJE	TIVOS DEL	TRABAJO DE SEMINARIO	1
RELA	TORIA DEL	TRABAJO DE SEMINARIO	2
CAPIT	TULO I	ANTECEDENTES DE LA PLANTA ENVASADOR DE CIANOCRILATO Y RESINA EPÓXICA	'A
1.1	ANTECED	ENTES	Ĺ,
1.2	DIAGRAMA	A DE FLUJO DE ENVASADO DE CIANOCRILATO	5
1.3	DIAGRAMA EPÓXICA	A DE FLUJO DE ENVASADO DE PLASTILINA	7
1.4	CONTROL	ESTADISTICO DE CALIDAD	9
1.5	LAS SIETE	HERRAMIENTAS BASICAS	12
CAPI	TULO II	HOJAS DE VERIFICACION.	
11 1	HOJAS DE	VERIFICACIÓN	14
11.2	COMO RE	ALIZAR UNA HOJA DE VERIFICACION.	16
11.3	APLICACIO	ÓN DE LAS HOJAS DE VERIFICACION	
	DEL ENVA	SADO DE CIANOCRILATO	17
[].4	APLICACIO	ÓN DE LAS HOJAS DE VERIFICACIÓN	
	DEL ENVA	SADO DE PLASTILINA EPÓXICA	24
Capi	tulo III	DIAGRAMA DE PARETO	
111.1	DIAGRAM	A DE PARETO.	30
111.2	APLICACI	ÓN DEL DIAGRAMA DE PARETO	36
CAP	TULO IV	GRAFICAS DE CONTROL	
IV 1	GRAFICA	S DE CONTROL	38
IV.2	GRAFICA	s≅-R <u> </u>	40
IV.3	APLICACI	ÓN DE LAS GRAFICA DE CONTROL X - R	43
NA	GRAFICA	"p"	45

IV.5	APLICACIÓN DE GRAFICA "P"									
CAPI	TULO V MUESTREO DE ACEPTACIÓN									
V.1	PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN	48								
V.2	MIL - STD - 105 - D	52								
V.3	APLICACIÓN DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN									
	POR ATRIBUTOS	58								
V.4	PROCEDIMIENTOS DE ACEPTACION POR									
	CARACTERISTICAS VARIABLES	59								
V.5	APLICACION DEL MUESTREO DE ACEPTACIÓN									
	POR VARIABLES	59								
V.6	PLAN DE MUESTREO DE VARIABLES	60								
V.7	OPERACIÓN DE UN PLAN DE MUESTREO DE VARIABLES	62								
8.V	MIL - STD - 414	63								
V.9	APLICACIÓN DEL MUESTREO POR VARIABLES	67								
CAP	ITULO VI PRUEBAS DE HIPOTESIS EN POBLACIONES									
	normales									
VI.1	PRUEBAS DE HIPOTESIS POR MEDIAS	69								
VI.2	· · · · = — · · · · ·									
	POBLACION NORMAL CON VARIANZA CONOCIDA	69								
VI.3	APLICACIÓN DE PRUEBA DE HIPÓTESIS	72								
CAP	itulo vii propuesta									
VII.1	PROPUESTA	74								
COP	NCLUSIONES	76								
818	Liografía	77								
apé	indice	79								

INDICE

OBJE	TIVOS DEL	TRABAJO DE SEMINARIO	1
RELA	TORIA DEL	TRABAJO DE SEMINARIO	2
CAPI	TULOI	antecedentes de la planta envasador de cianocrilato y resina epóxica	2A
1.1	ANTECED	ENTES	4
1.2	DIAGRAMA	DE FLUJO DE ENVASADO DE CIANOCRILATO	5
1.3	DIAGRAMA EPÓXICA	A DE FLUJO DE ENVASADO DE PLASTILINA	7
1.4	\	ESTADISTICO DE CALIDAD	9
	LAS SIETE	HERRAMIENTAS BASICAS	12
CAPI	TULO II	HOJAS DE VERIFICACION.	
11 1	HOJAS DE	VERIFICACIÓN	14
11.2	COMO REA	ALIZAR UNA HOJA DE VERIFICACION.	16
11 3	APLICACIO	ÓN DE LAS HOJAS DE VERIFICACION	
	DEL ENVA	SADO DE CIANOCRILATO	17
11.4	APLICACIO	ÓN DE LAS HOJAS DE VERIFICACIÓN	
	DEL ENVA	SADO DE PLASTILINA EPÓXICA	24
CAPI	TULO III	DIAGRAMA DE PARETO	
111.1	DIAGRAM	A DE PARETO.	30
111.2	APLICACIO	ÓN DEL DIAGRAMA DE PARETO	36
CAP	itulo iv	GRAFICAS DE CONTROL	
IV.1	GRAFICAS	S DE CONTROL	38
IV.2	GRAFICA:	S X – Ř	40
IV.3	APLICACI	ÓN DE LAS GRAFICA DE CONTROL X - R	43
V.A	GRAFICA	4P".	45

₩.5	APLICACIÓN E	DE GRAFICA "P"	46							
capi	TULO V M	uestreo de aceptación								
V.1	PROCEDIMIEN	ITOS DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN	48							
V.2	MIL - STD - 10	05 – D	52							
V.3	APLICACIÓN E	DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN								
	POR ATRIBUT	os	58							
V.4	PROCEDIMIEN	ITOS DE ACEPTACION POR								
	CARACTERIST	TICAS VARIABLES	59							
V.5	APLICACION E	DEL MUESTREO DE ACEPTACIÓN								
	POR VARIABL	ES	59							
V.6	PLAN DE MUE	STREO DE VARIABLES	60							
V.7	OPERACIÓN D	DE UN PLAN DE MUESTREO DE VARIABLES	62							
V.8	MIL - STD - 414									
V.9	APLICACIÓN E	DEL MUESTREO POR VARIABLES	67							
Capi	TULO VI P	RUEBAS DE HIPOTESIS EN POBLACIONES								
	N	ormales								
VI.1	PRUEBAS DE	HIPOTESIS POR MEDIAS	69							
VI.2	PRUEBAS DE	HIPOTESIS PARA LA MEDIA DE UNA								
	POBLACION P	NORMAL CON VARIANZA CONOCIDA	69							
VI.3	APLICACIÓN !	DE PRUEBA DE HIPÓTESIS	72							
CAP	tulo VII P	ROPUESTA								
VII.1	PROPUESTA		74							
CON	CLUSIONES		76							
BISL	iografía		77							
apé:	NDICE		79							

OBJETIVOS:

- Identificación de las herramientas estadísticas para ser aplicadas en una industria envasadora de cianocritato y plastilina epóxica.
- Llegar a la mejora de la calidad en la reducción del nivel de defectos y errores a través del uso de las herramientas estadísticas.
- Encontrar la comunión entre calidad y producción dada que la mejora de la calidad conlleva a la mejora de la productividad.

RELATORIA

- CAPITULO I En este capítulo básicamente se habla del control estadístico, de los antecedentes de la empresa, de sus diagramas de flujo y por último de las herramientas básicas.
- CAPITULO II En esta parte desarrollamos hojas de verificación y su aplicación tanto en el envasado de cianocrilato como en la de resina epóxica.
- CAPITULO III Se desarrolla el diagrama de Pareto como la aplicación práctica en el área de etiquetado interior que corresponde al proceso de envasado de cianocniato.
- CAPITULO IV

 Lo que corresponde a este capítulo se dedica a las gráficas de control X R y "p" con su respectiva aplicación, la primera en el área de llenado y la segunda en el etiquetado interior ambas correspondientes al envasado de cianocrilato.
- CAPITULO V Es donde se concentra más la atención el correspondiente trabajo ya que se había de la MIL STD 105 D y MIL STD 414 que corresponden respectivamente a características por atributos y variables para muestreo de aceptación, con su respectiva aplicación en el área de recibo de matenales.

- CAPITULO VI Prueba de hipótesis se desarrolla para poblaciones normales y también se hace su respectiva aplicación en recibo de materiales.
- CAPITULO VII La propuesta del trabajo es solamente una forma en las cuales se pueden usar las herramientas mencionadas en el mismo, pero no necesariamente debe ser el orden

CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LA PLANTA ENVASADORA DE CIANOCRILATO Y RESINA EPOXICA

Capitulo I antecedentes de la planta envasadora de Cianocrilato y resina epoxica

IM ANTECEDENTES

Krazy Kola Loka nace en la década de los 80 con el nombre de Cianomex, después por el 85 cambia de razón social a la que hoy conocernos comercialmente "KRAZY KOLA LOKA".

Esta se funda como un pequeño negocio donde todas las actividades se hacen manuales y su producción es muy pequeña, conforme el producto fue aceptado en el mercado como adhesivo instantáneo las necesidades de producir cada día más fue creciendo. Después del año 85 se empieza a producir en gran escala y al mismo tiempo se crea la planta de Plastiloka que produce resina y endurecedor epóxico y que ambos productos que son el adhesivo y la plastilina epóxica empieza a tener demanda en el mercado, el pequeño negocio pasa a formar una compañía en forma que se cataloga hoy en día como una empresa mediana.

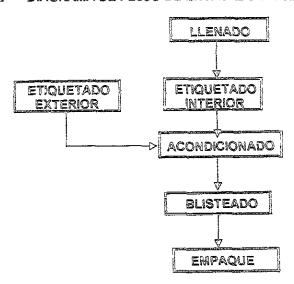
Entonces esta compañía empieza a crear toda una infraestructura para producir los productos mencionados en serie. El giro actual de esta organización es el envasado del adhesivo (Cianocrilato); en sus diferentes presentaciones de acuerdo a la viscosidad baja, mediana y alta.

- En la viscosidad baja solamente se envasa producto de 2g.
- En la viscosidad media se envasan presentaciones de 2g, 20g, 50g y 500g.
- Para la viscosidad alta se envasan presentaciones de 20g, 50g y 500g.
 Con lo que respecta a la plastilina epóxica se envasan presentaciones de 20g, 40g y 200g.

También se ha encargado de la distribución para lo cual se ha creado toda una serie de sucursales en todo el país y con eso tener cautivo el mercado con el slogan:

"PEGA DE LOCURA"

1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE ENVASADO DE CIANOCRILATO



DESCRIPCION DE LLENADO

Es la primera etapa del proceso donde se llenan los tubos y frascos donde se va a contener el Cianocrilato en sus diferentes presentaciones.

DESCRIPCION DE ETIQUETA INTERIOR

En esta etapa que por medio de unas maquinas etiquetadoras se coloca una etiqueta al tubo contenedor de 2g.

DESCRIPCION DE ETIQUETADO EXTERIOR

Es el área que por medio de una maquina etiquetadora se coloca una etiqueta al tubo contenedor, ilamado tubo exterior.

El etiquetado de las presentaciones de 20, 50 y 500g es manual.

DESCRIPCION DE ACONDICIONADO

Es el área donde un tubo contenedor o tubo exterior en el interior de éste se van a colocar el tubo contenedor de 2g, un dosificador de adhesivo (aplicador) y por ultimo un alfiler, para finalizar el tubo exterior se tapa.

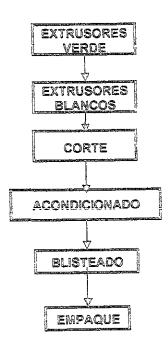
DESCRIPCION DE BLISTEADO

Es la etapa donde por medio de una máquina semiautomatizada se coloca dentro de una cápsula de blister el tubo exterior que después es tapado con una cartulina que a su vez pasa por una plancha que suministra calor y presión y que por medio de este mecanismo el blister se pega a la cartulina, tenienco finalmente el producto terminado.

DESCRIPCION DE EMPAQUE

Es la etapa final del proceso donde se empaca el producto en cajas que contienen cuarenta piezas a su vez estas se empacan en cajas que contienen cinco cajas individuales para tener al final un empaque de 200 piezas.

1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE ENVASADO DE PLASTILINA EPÓXICA



DESCRIPCION DE EXTRUSORES VERDES

Es el área donde la plastilina verde o endurecedor epóxico, se extruye obteniendo tiras que se cortan a la medida para que estas sean envueltas manualmente.

DESCRIPCION DE EXTRUSORES BLANCA

Es la etapa donde también sé extruye la plastilina blanca o resina obteniendo tiras que se envuelven junto a la tira verde operación que se lleva manualmente.

DESCRIPCION DE CORTE

En esta área solamente con la ayuda de una guillotina se corta la tira en dos partes iguales.

DESCRIPCION DE ACONDICIONADO

En el área de acondicionado se hace una selección del material separado aquel que tenga defectos y colocando el mismo que no los tenga en una burbuja de blister.

DESCRIPCION DE BLISTEADO

Es la etapa donde por medio de una máquina semiautomática se coloca dentro del blister las tiras que son colocadas en una cavidad que después es tapada con una cartulina que a su vez pasa por una plancha que suministra calor y presión y que por medio de este mecanismo el blister se pega a la cartulina, teniendo finalmente el producto terminado.

DESCRIPCION DE EMPAQUE

Es la etapa final del proceso donde se empaca el producto en cajas que contienen 50 piezas a su vez, estas se empacan en cajas que contienen 5 cajas individuales para tener al final un empaque de 250 piezas.

LA CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

Shewhart fue el primero en reconocer que en toda producción industrial se da variación en el proceso.

Esta variación debe ser estudiada con los principios de la probabilidad y la estadística. Observó que no pueden producirse dos partes con las mismas especificaciones lo cual se debe entre otras cosas a las diferencias que se dan en la materia prima, a las habilidades de los operadores y a las condiciones en que se encuentra el equipo. Más aún se da variación aún en las piezas producidas por un mismo operador y la misma maquinaria.

La administración debe tomar en cuenta este hecho relacionado íntimamente con el problema de la calidad. No se trata de suprimir la variación – esto resulta prácticamente imposible- si no de ver que rango de variación es aceptable sin que se originen problemas. El análisis expuesto tuvo su origen en el concepto de control estacístico de Shewhart.

"Se dice que un fenómeno se controla cuando, con base en experiencias anteriores, podemos predecir, al menos dentro de ciertos límites, como esperamos que el fenómeno va a variar en el futuro. esta predicción significa que podemos establecer, en forma al menos aproximada, la probabilidad con la que el fenómeno observado se va a dar dentro de cierto límites."

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores Shewhart desarrolló técnicas estadísticas. Sencillas para determinar dichos límites y gráficos de control en las que se pudieran presentar los resultados.

Mientras Shewhart proseguía su trabajo con respecto al control del proceso, otros investigadores de la misma compañía, principalmente Harol Dodge y Darry Romining, avanzaban en la forma de llevar a cabo la práctica de muestreo, que es el segundo elemento más importante del control estadístico.

Las técnicas de muestreo parten del hecho de que en una producción masiva en imposible inspeccionar todos los productos, para diferenciar los productos buenos de los malos.

De ahí la necesidad de verificar un cierto número de artículos entresacados de un mismo lote de producción para decidir sobre esta base si el lote entero es aceptable o no.

Sin embargo, esta forma de proceder incluye riesgos; debido a los defectos de unas cuantas muestras se puede rechazar todo un lote de producción de calidad aceptable, como también se puede pasar como bueno un lote que en realidad debería ser rechazado. Los investigadores, que consideraron este problema como riesgo del productor y del consumidor, desarrollaron también algunas técnicas para solventarlo.

La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de producir armamento en grandes cantidades fueron la ocasión para que se aplicaran con mayor amplitud los conceptos y las técnicas de control estadístico de la calidad.

En diciembre de 1940, el departamento de Guerra Estados Unidos formó un comité para establecer estándares de calidad. Dicho departamento se enfrento con el problema de determinar los niveles aceptables de calidad de las armas e instrumentos estratégicos proporcionados por diferentes proveedoras. Se presentaran alternativas o se daba un entretenimiento masivo a los contratistas en el uso de las gráficas del control del proceso, o bien se desarrollaba un sistema de procedimientos de aceptación mediante un sistema de muestreo a ser aplicado por inspectores del gobierno se optó por esta segunda forma de proceder, y en 1942 el departamento de guerra estableció la sección de control de calidad, organismo en el que ocuparon puestos relevantes algunos especialistas en estadística de la compañía Bell Telephone Laboratones.

Este grupo desarrolló pronto un conjunto de tablas de muestreo basadas en el concepto de niveles aceptable de calidad (Aceptable quality leves AQL). En ellas se determinaba el máximo por ciento de defectos que se podía tolerar para que la producción de un proveedor pudiera ser considerada satisfactoria.

La necesidad de elaborar programas de entrenamiento en asuntos referentes al control de calidad, con la cooperación de importantes universidades de Estados Unidos, fue la ocasión para que los conceptos y las técnicas del control estadístico se introdujeran en el ámbito universitario. Los estudiantes que habían tomado curso comenzaron a integrar sociedades locales de control de calidad. Fue así como se originó la American Society For Quality Control (ASQC) y otra más.

A fines de la década de los cuarenta, el control de la calidad era parte ya de la enseñanza académica. Sin embargo, se les consideraba únicamente desde el punto de vista estadístico y se creía que el ámbito de su aplicación se reducía, en la práctica, al departamento de manufactura y producción.

1.5 LAS SIETE HERRAMIENTAS BÁSICAS

Los métodos de control de calidad se originaron en los Estados Unidos de América y países europeos y fueron introducidos a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Han sido usados ampliamente en las industrias japonesas durante los últimos 40 años y como se sabe, son la base para la superioridad de los actuales productos japoneses.

Estos métodos, han sido retirados para ser simplificados y fáciles de aplicar y sus principales características se resumen de la siguiente manera.

- 1. Puede aplicarse a la planta con el equipo y facilidades existentes; es decir, con los recursos con que cuenta la empresa.
- 2. Cualquiera que cuente con la educación superior puede manejarlos.
- 3. Todo lo que se necesita son siete herramientas básicas para su aplicación.

Las tres características mencionadas muestran que los métodos pueden manejarse fácilmente y son aplicables para todos los ingenieros que anhelan lograr un alto nivel de control de calidad y productividad mejorada.

Según Ishikawa, las herramientas básicas son un conjunto de técnicas de planeación y análisis que, utilizadas adecuadamente, permiten resolver el 95% de los problemas de la empresa.

Un enfoque importante de las herramientas básicas es el contribuir a identificar las causas principales de la variabilidad.

Para obtener la información que se necesita, se requiere conocer el objeto de estudio, el tipo de acción o decisión que se desea tomar, los cursos y el tiempo que se dispone para abordar el problema.

Las siete herramientas básicas son el medio más efectivo para resolver problemas de planta sin:

- a) Cambiar facilidades y equipo presente.
- b) Reemplazar a los trabajadores actuales.
- c) Altos costos.

Éstas herramientas son las siguientes:

- 1) Diagrama de Pareto.
- 2) Diagrama de causa efecto(Ishikawa)
- 3) Histogramas.
- 4) Estratificación.
- 5) Hojas de venficación.
- 6) Diagrama de dispersión.
- 7) Gráficas de control.

CAPITULO II HOJAS DE VERIFICACION.

11.1 HOJAS DE VERIFICACION

La hoja de verificación es un formato diseñado para recabar datos, que facilita su análisis. A simple vista permite apreciar la magnitud y localización de los problemas principales. Es una herramienta poderosa en la mejora continua dal proceso.

Dentro de un proceso y en cualquier otra aplicación la información debe tener la suficiente confiabilidad para poder utilizada con la finalidad e lograr un control de calidad.

La información requiere mucha concentración y paciencia en el momento de su colección y registro, es esencial la precisión y confiabilidad para su procesamiento; por esta razón se prepara un método fácil y simple que utilizaran los trabajadores para la recopilación de información ya que estos van a ser los responsables de coleccionada; uno de esos métodos fácil y simple que utilizaran los trabajadores para la recopilación de información ya que estos van a ser los responsables de coleccionada; uno de estos métodos es la hoja de verificación.

La hoja de verificación es multifuncional, es muy útil para aquellos que reúnen la información y para quienes la procesan.

Su función más importante es la simplificación del proceso de reunir y preparar información para facilitar los procesos estadísticos que tengan que ser aplicados.

Su aplicación tiene como objeto comprobar de manera constante si se han recabado los datos solicitados y se han efectuado determinados flujos.

Aplicación:

Describe resultados de operación o inspección.

Examina artículos defectuosos, identificando tipo de falla, área de procedencia, la máquina, el operador, el material, la fecha, etc.

Confirma causas del problema. Analiza y verifica operaciones y el efecto de los planes de mejora.

Es una etapa dentro del Análisis de Pareto y de una estratificación.

Su diseño permite que se elabore una distribución de un proceso, él numero de defectos y su localización, el tipo de causas de los defectos.

11.2 COMO REALIZAR UNA HOJA DE VERIFICACION.

Para su preparación no existe una regla definida; puede servir cualquier forma siempre y cuando sea fácil de llenarse y conveniente para el siguiente manejo de información. El contenido de estas hojas es el siguiente.

- Se registran los datos generales a los que se refieren las observaciones o venficaciones por hacer, como encabezado.
- 2.- Se recolectan los resultados de dichas observaciones en la parte infenor.

Para verificar los defectos, el siguiente formato se utiliza.

VERIFICAC	ion de defectos	
PRODUCTO:	FE(CHA:
ETAPA DE FABRICACIÓN:	SEC	CCION.
TIPOPS DE DEFECTOS:		
	ELABOR	0:
COMENTARIOS:		
	ORDEN	/10:
TIPO:	CHEQUEOS:	SUBTOTAL:
Α		
B:		
C:		
D:		
E:		
F		
TOTAL DE INSPECCIO	DNADOS:	
TOTAL DE RECHAZAC	DOS:	

II.3 APLICACIÓN DE LAS HOJAS DE VERIFICACIÓN DEL EMBASADO DE CIANOCRILATO

La aplicación muy particular de las hojas de venficación en el proceso de envasado de Cianocrilato son:

- Area de llenado.
- Area de etiquetados.
- · Area de acondicionado.
- Area de blisteado.
- o Area de empaque.

ARE	ca de	LLEN	AIDO			I	EQUIPO) N -			
DEL	·	_ A <u>ī</u>				1	NSPEC	TOR T			-
DIA	нова	TAMAÑO LOTE	Tamaño Muestra	HOLGURA TAPON	PESO PROMEDIO	PESO TUBO	PESO NETO	LIMPIEZA DE TUBO	CONTAMINA- DOS	SINADHESIVO	FIRMA SUPERVISOR
				<u> </u>							
		.l	<u></u>		.l	<u>i</u>	l	1	<u></u>	J	1
OB:	SERVA	CIONE	S								

AREA DE ETIQUETADO INTERIOR

DEI			AL	<u>.</u>					
DIA	HORA.	ARRUGADO	ALTO/BAJO	SUCIO	CHUECOS	MAL Cerrado	SIN ADHESIVO	CONTAMINA- BOS	FIRMA SUPERVISOR
			, } }						
			; ;						\$
1	1		i .			-			·
OB:	SERVAC	IONES			·				

AREA DE ETIQUETADO EXTERIOR

DIA	HORA	PRODUCTO	LOTE DE ETIQUETA	REMISION	ARRUGADO	ALTO/BAJO	CHUECOS	DESPIEGADOS	DEFORMADOS	orros	FIRMA
=		2	38	2 %	₹	₩			-		
•						<u></u>					

AREA DE ACONDICIONADO

DEL	 		AL		·					
DIA	HORA	SIN ALFILER	DOBLE	SIN	DOBLE	MAL TAPADO	INSERVIBLE	SINADHESIVO	socios	FIRMA SUPERIOR
							-]		
							1			
OBS	ERVACI	ONES			······					
		,								

ARI	a Di	e blis	FER				I	EQUI	PO N					
DEI	<u>.</u>		A	Ľ			See .	nspi	ECTO	R	. <u></u>			
		S DE JCTO	AJE.	2	ER.		CAV TA	'IDA Pac		3		IND. I		firma Supervisor
DIA	HORA	CLAVE DE PRODUCTO	ANCLAJE	BLISTER	BLISTER	MOI.	MOL,	MOI.	MOL	MOL	PRES	TEMP	TPO	FIRM
	 										-			
ļ 	;									ļ	-		-	
	· •		ļ 								-			
	; ;		<u> </u>						-		-			[
	<u>. </u>								<u> </u>	-	-			
OBS	SERV	ACION	ES		<u> </u>	1	<u></u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	
	·								,					
	·					-								

ARE	a Di	e empaç	QUE			EQU	M OPIN	°			
DEI			_ AL			INS	PECTC	R			
		re/	Aib	EGIBLE		TUBO RAD			ntid Dita		SOR
DIA	HORA	EXEDENTE (CINTA DE SEGURIDAD	CLAVE LEGIBLE	EMPAQ	EMPAQ 2	EMPAQ 3	£MPAQ 1	entpaq 2	£MPAQ 3	FIRMA SUPERVISOR
_											
									<u> </u>		
	!										
	,			}						}	
	!										
CBS	SERV	ACIONES	5								

II.4 APLICACIÓN DE LAS HOJAS DE VERIFICACIÓN DEL ENVASADO DE PLASTILINA EPOXICA

Para la aplicación de las hojas de verificación muy particular del envasado de la plastilina epóxica son:

- Area de extrusores verdes.
- Area de extrusores blancos
- Area de corte .
- Area de acondicionado.
- Area de blister.
- Area de empaque.

:ATOM

La hoja de verificación de los extrusores es idéntica para extrusores verdes como blancos.

EXTRUSOR:

PERIODO:

nombre Del Auxiliar	HORA	TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE MUESTRA	TIRA ANCHA	TIRA ANGOSTA	DIFERENTES ANCHOS	BURBUJA	EGPESOR	CONTAMINADA	RUGOSA	INCOMPLETA	OBSERVA- CIONES
									:			
							,					
							!					
									-			
TOTALES							 					

LINEA DE CORTE

FECHA:

AUXILIAR DE PRODUCCION	LOTE	MUESTRA	СНИЕСО	REBABA	CONTAMINADA	CORTAS	LARGAS	SESGADO	OBSERVA- CIONES
							Print and the second		

LINEA DE ACONDICIONADO

FECHA:

auxiliar de Produccion	TAM. DEL LOTE	TAM. DE MUESTRA	DOBLE BLISTER	PLST	BLISTER SUCIO	DIF. ANCHOS	RUGOSIDAD	POROSIDAD	TIRAS	BURBUJA M. RES	PLASTICO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

Linea de Blister

Fecha	
HORA	
ANCLAJE	
SELLO	
RECARGADOS	t
ALTOS	
BAJOS	
ENCHINADO	
DEFORMADO	
DOBLE BLISTER	
MARCADOS	
SUCIOS	
PRESION	
TEMPERATURA	
Tiempo de sellado	1

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

Linea de empaque

Fecha	
HORA	
CLAVE DE PRODUCTO	
CARTULINA MALTRATADA	
CARTULINA ROTA	
SOBRANTES	
FALTANTES	
PIEZAS DESPEGADAS	
CINTA ARRUGADA	
CINTA CHUECA	
CINTA DESPEGADA	
CAJAS SUCIAS	
CAJA MALTRATADA	
OTROS	
1	

CAPITULO III DIAGRAMA DE PARETO

III.1 DIAGRAMA DE PARETO

En todo tipo de procesos de producción existen aspectos que pueden y deben ser mejorados, o bien se presentan problemas que se deben ser solucionados: por ejemplo: productos fuera de especificaciones, defectos del proceso de fabricación, defectos de instalación de piezas, etc.

Todos los problemas son provocados en general por varias causas, por lo que resulta difícil de saber como atacarios. Además, no todos los problemas tienen la misma importancia y, por otro lado, no es posible resolvedos al mismo tiempo; por esta razón, conviene asignar prioridades a los distintos problemas e intentar resolver primero los de mayor magnitud o importancia.

El diagrama de Pareto, es una gráfica que presenta en forma ordenada, en cuanto a importancia o magnitud, la frecuencia de la ocurrencia de las distintas fallas. En esta gráfica, en el eje horizontal, se indican los tipos de defectos o características fuera de especificación que son los factores que causan que las piezas se consideren defectuosas. Cada barra representa un tipo diferente de efecto y su altura, la frecuencia del defecto o factor correspondiente, se localiza al mayor ocurrencia a la izquierda y al de menor importancia a la derecha. De esta manera el diagrama de Pareto indica cuales fallas deben atacarse primero en términos de su contribución ai problema para eliminarlas y mejorar la operación. El proyecto de solución debe alcanzar los mayores beneficios al menor esfuerzo.

El principio de Pareto conocido como "80-20" o pocos vitales y muchos triviales, reconoce que el 20% de los elementos generan el 80% del efecto y el resto de los elementos (80%) generan sólo el 20% del efecto. De los problemas de la empresa, sólo unos pocos son los importantes. Localiza problemas vitales para concentrar esfuerzos en la solución de estos.

También identifica las pocas causas fundamentales de un problema vital que podrá reducir las fallas y deficiencias de la empresa

Es el primer paso para un proyecto de mejora y muy útil para motivar la cooperación de los involucrados en el problema.

Una vez que se han implantado los cambios al proceso, se realiza nuevamente el estudio y se observa fácilmente el cambio que se ha logrado.

CARACTERISTICAS

El eje horizontal abarca diferentes tipos de variables; tipo de defectos, grupo de trabajo, tamaño de máquina, obrero, turno, fecha de fabricación, cliente proveedor, método de trabajo, etc.

El eje vertical izquierdo representa la frecuencia o las unidades de medida de la categoría o vanable.

El eje vertical derecho representa el % acumulado para evaluar la importancia de cada categoría, respecto a las demás.

Si la categoría de mayor frecuencia es significativamente más importante a las demás duplicará a la suma total de las demás categorías.

Cuando a ninguna de las categorías predomina y el diagrama tiene apanencia plana, significa que deba reanalizarse el problema.

ELABORACIÓN

Hacer una lista de los factores o causas potenciales que posiblemente provocaron el problema ya detectado, pueden considerarse:

- Características fuera de especificación.
- Tipos de defectos.
- Partes o piezas dañadas.
- Fallas en el funcionamiento de las partes que conforman el producto.
- Los factores de menor importancia se pueden resumir en un rubro llamado "otros".
- Establecer y determinar el periodo en que se obtendrán los datos. Este puede ser un mes una semana, un día, etc. (no existe un periodo preestablecido este dependerá de la situación).
- Se obtienen en dicho periodo los datos sobre la ocurrencia de cada rubro (causa o tipo de defecto); utilizando una hoja de registro, el número total de piezas o casos inspeccionados.
- 4. De acuerdo a lo recabado en el punto anterior se ordenan los rubros de acuerdo a su frecuencia, de mayor ocurrencia.
 En la hoja de registros se anotan las ocurrencia de cada rubro determinado el numero de casos que resultaron defectuosos en el total inspeccionado (d) (Ver tabla de fórmulas) inspeccionado(N).
- 5. Se calcula el porcentaje absoluto (ai) de cada uno de los rubros. Con este cálculo se puede saber que mejora se lograría dentro de la producción o método de producción, si se elimina algún defecto tomando acciones correctivas para correginos (ver tabla de fórmulas).
- Se calcula el porcentaje relativo de piezas defectuosas (Rin) para cada uno de los rubros, respecto al número total de casos defectuosos (d) (ver tabla de fórmulas)
- Todos los cálculos anteriores se anotaran en la hoja de registros (ver hoja de registros).

- 8. Todos los cálculos antenores se anotarán en la hoja de registros (ver hoja de registro).
- 9. Se traza el eje horizontal y los ejes verticales.
 - En el eje horizontal, se determina el tamaño de la división (ver hoja de recomienda de a 2 cm.)
 - En el eje vertical izquierdo, se selecciona una división de números enteros, adecuada, para representar el número de ocurrencias (ni) de cada rubro. Esta escala debe incluir el número total de defectos (d).
 - La función del eje vertical derecho, es representar el porcentaje relativo acumulado (Ri) y su escala se divide generalmente en cuatro partes (25,50,75 y 100%), para poder apreciar el efecto de las acciones tomadas de los procesos.
- 10. Se construye las barras de cada uno de los rubros, la altura representada su ocurrencia (ni), la amplitud de las barras es de la misma y deben estar conectadas unas con otras.

FECHA				
NO. total de insp	ecciones			
Tipo de defecto	No. de casos ocurrencia	Porcentaje absoluto de defectos	Porcentaje relativo de defectuosos	Porcentaje relativo acumulado
m,	?] ₁	a _i — 100	n _i ———— 100 d	R, 11 12 13 Im
A B C D E F G H L J K L M				
TOTAL	d	X%	100%	100%

Ocumencia Nº de defectos

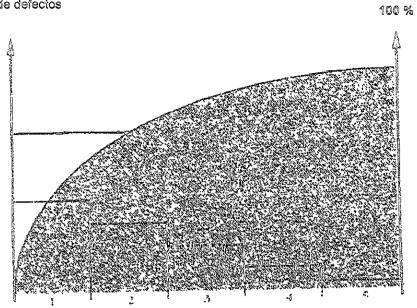


FIGURA: 3.1

111.2 APLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE PARETO

La siguiente tabla muestra el número de defectos sacados de una hoja de verificación del Proceso de Envasado de Cianocrilato del área de etiquetado interior de la semana que comprende del 26 de junio al 02 de julio del 2000

REGISTRO		s en el área i 16 al 2 de julk	DE ETIQUETADO	INTERIOR
Defecto	Frecuencia de Ocurrencia n ₄	%Absoluto de defectos. a ₁ %= n ₁ x100	% Relativos de defectos.	%Relativo Acumulado j Rj= Σ ri i=1
Arrugado	49	5.4%	28%	28%
Chuecos	48	5.3%	27.42%	55.42%
Alto o baio	42	4.6%	24%	79.42%
Sucios	36	4%	20.57%	99.99%
Sin adhesivo	0	0%	0%	
Contaminado	0	0%	0%	
	d=175	19.3%	99.99%	

N= Total de piezas inspeccionadas:

Se toman 50 piezas en cada inspección y el número de inspecciones fueron 18 por tanto el número de total de piezas inspeccionadas será:

$$N = 18 \times 50 = 900 Pzas$$

Calculo de a1:

$$a_1\% = 49 \times 100 = 54$$

900

Cálculo de ra

13% = 40 X 100 = 28%

175

El diagrama de Pareto para este problema es entonces el siguiente.

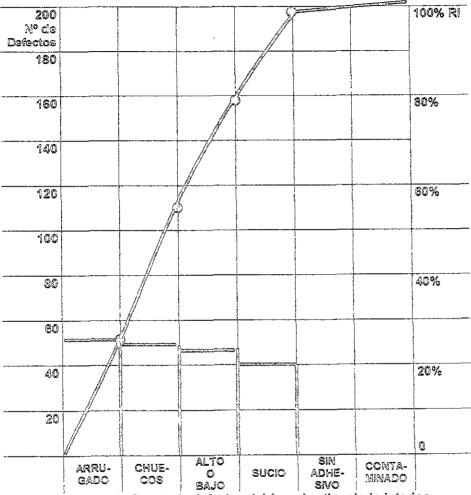


Diagrama de Pareto de defectos del área de etiquetado interior

ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE PARETO RESULTANTE

El 28% de los defectos acruales es resultado de la arruga, se tendría que investigar las causas de este problema.

CAPITULO IV GRAFICAS DE CONTROL

IV.1 GRAFICAS DE CONTROL

Uno de los pioneros de la estadística en control de calidad fue el Doctor W. A. Shewhart. las gráficas para el control de calidad de los procesos es uno de los métodos mas utilizados actualmente, prevaleciendo el enfoque que le dio el Dr. Shewhart

Los productos deben cumplir y satisfacer completamente las necesidades de los compradores y/o consumidores; para ello, los fabricantes deben establecer metas precisas de fabricación económicas y de calidad; después, se debe controlar el proceso de producción, para elaborar estos productos con una calidad uniforme y económicamente posible.

Para producir con una calidad uniforme, se necesita establecer y cumplir con los estándares de manera correcta por los trabajadores. La variabilidad de los resultados de las características de calidad, puede aumentar por causas especiales (imprevistas); es por esto que deben revisarse continuamente para confirmar si los productos cumplen con las características que satisfacen los estándares o los requerimientos del comprador. De no ser así, deben tomarse las medidas correctivas de manera inmediata.

Las graficas de control se pueden definir en general como una forma de visualizar y evaluar el control de los procesos, tomando como base de evaluación las características de calidad establecidas. (Es decir, si esta el proceso bajo control o no).

Permite también observar y tener evidencias del comportamiento de los procesos de manera cronológica, porque estas gráficas incluyen medidas de tendencia central (media) del proceso, así como la variación de las características reales (amplitud de variación) de calidad.

La gráfica de control compara características de calidad, (las reales) con los iímites de control, estableciendo así la variación, detectando las causas comunes y especiales; al detectarse estas últimas se generan las acciones correctivas del proceso.

Estas gráficas consisten en una línea central en donde se sitúa el promedio o media y dos líneas paralelas que corresponden a los limites de control superior e inferior.

Generalmente la tínea del promedio es continua y azul, en tanto que los limites de control son líneas punteadas de color rojo, (como señal de alarma).

Es importante no confundir los limites de control con los limites de especificación (los límites de especificaciones son los que marcan las tolerancias de diseño).

Los limites de control se determinan en base a unas muestras representativas del proceso (universo) Para calcularlos adecuadamente la muestra deberá dar información suficiente y veraz, con el fin de obtener mayor confiabilidad al momento de realizar las gráficas.

Estas graficas se aplican y desarrollan en el control de diversas áreas, como son materias primas productos en proceso y productos terminados.

Es interesante comprobar que estas cartas de control nos arrojan una gran cantidad de información, de manera que engloban varios aspectos del proceso; es por esto que nosotros creemos que es una de las herramientas estadísticas más importantes.

Los tipos de gráficas de control se clasifican de acuerdo a la características que se va a observar y/o al tipo de proceso que se va a controlar; estas pueden ser de dos tipos:

- De una característica cuantitativa (por variables)
- De una característica cualitativa (por atributos)

POR VARIABLES:

- 。 X R Individual y rango móvil
- ∘ X R Promedios y rangos
- 。 X S Desviación estándar

POR ATRIBUTOS:

- o p Porcentaie de unidades defectuosas
- np Cantidades de unidades defectuosas
- o e Número de defectos por lote
- ະ ແ Cantidad de defectos por unidad de inspección

IV.2 GRAFICAS X-R

La sección de las variables que se van a utilizar estarán en base al objetivo o con el propósito de eliminar o minimizar los rechazos, los costos de la calidad, el scrap (desperdicios), los retrabajos etc.

Las variables o características que se utilizan en estas gráficas son cuantitativas, es decir que pueden ser medidas y se expresan en números; por ejemplo dimensiones, pesos, conductividad eléctrica, densidad, temperatura, etc. De esta manera el control se puede realizar de manera más exacta y objetiva

El criterio para la selección de datos esta en base al volumen de producción, tiempo de recorrido, etc. También se determinan el tamaño de muestra y frecuencia de las observaciones.

Al iniciar la toma de datos para saber el comportamiento de un proceso, las muestras (sub – grupos) deberán ser de dos o más piezas; se recomiendan cinco piezas, estas son producidas consecutivamente para poder asegurar que están hechas bajo las mismas condiciones de producción, la frecuencia debe ser en cortos periodos de tiempo con el fin de mostrar si el proceso es inconsistente o muestra cambios cíclicos, que no podrían detectar con periodos más largos.

Es básico para la funcionalidad de la gráfica que se tenga un método de registro de datos por escrito y que sea de completo dominio del personal; esto con la finalidad de que la medición sea uniforme y los datos realmente representen el comportamiento del proceso o característica.

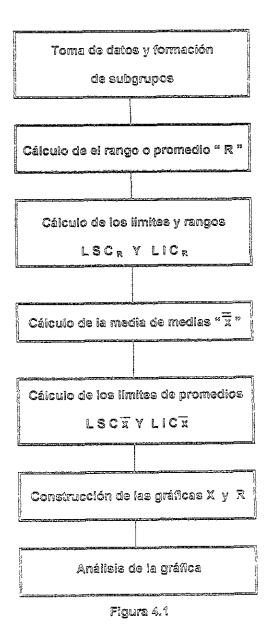
Los procedimientos para la elaboración de cada una de las graficas de variables, son los siguientes:

Gráfica X - R

La media (\overline{x}) y el rango de cada subgrupo será graficado como un punto de esta gráfica; la unión de todos los puntos (subgrupos) por líneas rectas conformarán la gráfica.

La grafica X - R se utiliza cuando lo que se analiza son grandes lotes de producción sacando de estos los subgrupos (muestras)

El procedimiento de elaboración se describe en el diagrama de bloques:



42

IV.3 APLICACIÓN DE LAS GRÁFICAS DE CONTROL X - R

Se recopilan 29 subgrupos de datos con 5 elementos cada uno, estos son de pesos del adhesivo de la presentación de 2g, que corresponde al periodo del 19 de junio al 3 de julio.

Se aplicará la gráfica de control \overline{X} - \overline{R} donde:

$$=\frac{\Sigma X}{X} = \frac{\Sigma X}{K}$$
, $R = \frac{\Sigma R}{K}$

$$LCS_{\overline{x}} = \overline{\overline{X}} + A_2R$$

$$LC_{\overline{x}} = \overline{X}$$

$$= \sum_{\mathbb{X}} \mathbb{X} = \frac{\sum_{\mathbb{X}} \mathbb{X}}{\mathbb{X}} = 1.924$$

$$= \sum_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$$
 = .035

CALCULO DE LOS LIMITES DE CONTROL

Para subgrupos de 5 elementos ver la tabla incluida en la gráfica $A_2 = 0.58$

L C
$$S_{\overline{X}}$$
 = 1.924 ÷ 0.58(0.035)
=1.944
L $C_{\overline{X}}$ = 1.924
L C $I_{\overline{X}}$ = 1.924-0.58(0.035)
=1.903

Para subgrupos de 5 elementos ver la tabla incluida en la gráfica.

$$D_4 = 2.11 \text{ y } D_3 = 0$$

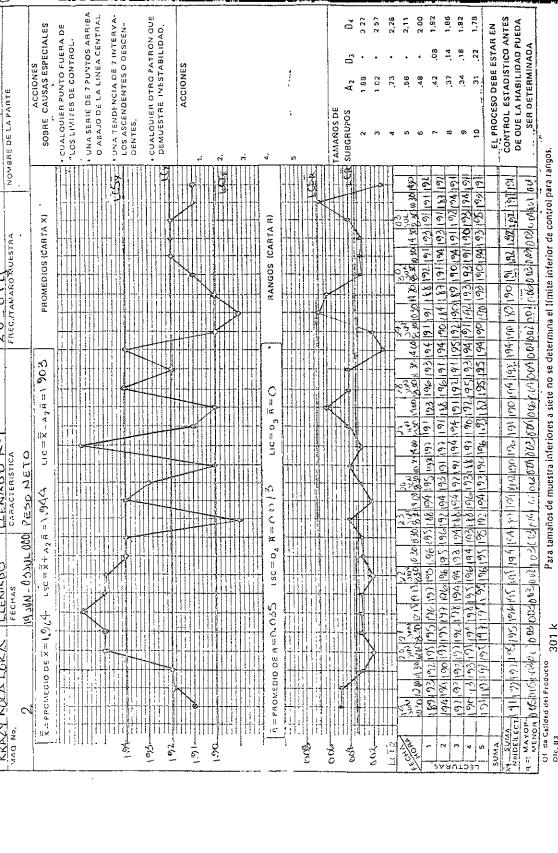
 $L C S \overline{R} = 2.11(0.035)$
 $= 0.073$
 $L C \overline{R} = 0.035$
 $L C \overline{R} = 0(0.035)=0$

- Construcción de la gráfica.
- Análisis de la gráfica.

No se encuentra en control estadístico.

En la parte de las medias se encuentran puntos fuera de control tanto en el limite superior como en el inferior, se tendría que investigar las causas que ocasionan este comportamiento.

Se observa en la parte de los rangos una variabilidad constante al principio pero a lo largo del tiempo esta va haciendo mas disparada también habría que investigar las causas especiales que provocan esto.



IV.4 GRÁFICA "p"

Este tipo de gráficas nos sirve para recabar información acerca de las proporciones defectuosas del total inspeccionado (las piezas defectuosas de la muestra), en un determinado tiempo; descubre e identifica los puntos fuera de control en los que se deben tomar acciones para corregir los defectos y así tener una opción para mejorar la calidad de manera constante.

Se utiliza cuando el tamaño de muestra no es constante; por esta razón se obtienen y manejan porciones.

Procedimiento para la elaboración de la gráfica "p".

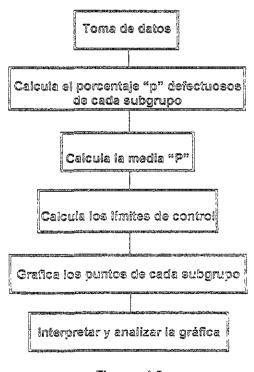


Figura 4.2

Si varia en \div , \sim 25% y los subgrupos están dentro de esta tolerancia los limites se calculan con n, de otra forma se calcula con el valor n de cada subgrupo y para cada subgrupo.

IV.5 APLICACIÓN DE LAS GRÁFICAS DE CONTROL "P".

Se toman datos del número de piezas defectuosas del área de etiquetado interior correspondiente al envasado de Cianocrilato en un periodo de 18 días.

Se aplicará la gráfica de control P.

	Día	n	No piezas "no pasa"	Fracción p
	1	50	9	0.18
	2	50	10	0.2
	2 3	50	17	0.34
	4	50	19	0.38
	5	50	22	0.44
	6	50	14	0.28
	7	50	19	0 38
	8	50	14	0 28
	9	50	12	0 24
	10	50	13	0.26
	11	50	10	02
	12	50	10	0.2
	13	50	12	0.24
	14	50	10	0.2
	15	50	8	0.16
	16	50	7	0 14
	17	50	6	0.12
	18	50	8	0.16
	19	50	7	0.14
-	Total	950	227	4.54

Donde:

n = cte = 50 piezas

Mp = Total de unidades defectuosas

Modern Total de unidades examinadas

$$Cp = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

$$LSCp = P+3 \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

LIC = P-3
$$\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

$$\overline{P} = \frac{227}{950} = 0.238$$

$$\text{Gp} = \sqrt{\frac{0.238 \text{ (1-0.238)}}{50}}$$

$$LSC = p + 3 \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

$$LIC = P - 3\sqrt{\frac{P(1 - P)}{n}}$$

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA:

Un punto se sale de los limites de control y después va disminuyendo el porcentaje de defectuosos, habría que investigar la causa especial que obedece a este comportamiento.

TIPO DE EVALUACION		CONSTANTE [] DIFFRENTE []	(R.1) - (R.1)
TIPOD		CONS	30 TOT
	,		8
AK.			2
FRECUENCIA			
	 		
MAQUINA		lu l	
2			
1			8
		الم	
			9
		la.	
UTOS			
ATRIB	10		
FOR 1	DEFECTUS		
ONTRO	DEF	JA .	
GRAFICA DE CONTROL POR ATRIBUTOS	CARACTÉRISTICA	FSP NOMINAL	
AFICA	CTERIS	FSP	2
g	CARA		
	ERIOR	, S E	
ĺ	12	TICO	
	00%	I FEM CRITICO	
: ** 128 128	AREA ETIQUETADO INT		
201 100 100 100 100 100 100 100 100 100		TIPO DE CARTA	
Revi	11.1 12.1 13.1	TIPO DE	No DE LOTE STANNO OF

CAPITULO V MUESTREO DE ACEPTACION

V.1 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Formas de muestreo. Los planes de muestreo pueden clasificarse en dos tipos: planes por atributos y planes por variables.

Planes por atributos. En estos planes, se toma una muestra del lote y se clasifica cada unidad como conforme o no conforme El numero de disconformidades es, entonces, comparado con el número de aceptación establecido en el plan, y se toma la decisión de aceptar o rechazar el lote. Los planes por atributos pueden además, ser clasificados según uno de los dos siguientes criterios básicos:

- Planes que, admitiendo determinados nesgos de muestreo, proporcionan protección lote por lote. Estos riesgos son:
 - a. En cada lote, un determinado nivel de calidad (en términos de porcentaje defectuoso) tiene un cierto nesgo (digamos 0,10) de ser aceptado por el comprador. Ese nivel de calidad es conocido como porcentaje de unidades defectuosas toleradas en el lote (p₂); el nesgo elegido es conocido como riesgo del comprador (β).
 - b El plan de muestreo aceptará un cierto porcentaje (digamos un 95 por 100) de los lotes inspeccionados que tengan un determinado nível de calidad. Este nível de calidad es llamado nível de calidad aceptable (NCA). El riesgo de rechazar un lote de NCA (p,) es conocido como riesgo del vendedor (CC).
- Planes que proporcionan un limitado porcentaje medio de artículos defectuosos, a lo largo de la fabricación. Este valor se conoce como limite de calidad media de salida (LCMS)

Planes por variables. En estos planes, se toma una muestra y se mide una determinada característica de la calidad, en cada unidad. Estas mediciones son luego resumidas en un estadístico sencillo (por ejemplo, la media de la muestra) y los valores observados se comparan con un valor admitido que se define en el plan. A continuación, se toma la decisión de aceptar o rechazar el lote. Cuando se pueden aplicar, los planes por variables proporcionan el mismo grado de protección al comprador que los planes por atributos aunque utilizan muestras considerablemente menores.

Los planes por atributos son aplicados, generalmente, en base al porcentaje defectuoso, es decir, para controlar la proporción de producto aceptado que es defectuoso o que esta fuera de especificación. Los planes por variables para porcentaje de unidades defectuosas son también utilizados con este objeto. Estos tienen mayor sensibilidad, pero requieren que la forma de la distribución de las medidas individuales sea conocida y estable. La forma de la distribución es utilizada para traducir la proporción defectuosa en valores específicos de los parámetros del proceso (medía, desviación tipo) que son entonces controlados.

Los planes por vanables son también utilizados para controlar los parámetros del proceso cuando las especificaciones se refieren a su media o a su variabilidad, y no especificamele al porcentaje defectuoso. Estos planes no requieren necesariamente un conocimiento detallado de la forma de la distribución de las mediciones individuales

Los planes de muestreo utilizados en fiabilidad y en el muestreo de materiales a granel son generalmente de éste tipo. Sin embargo, los que se han publicado en el área de la fiabilidad, habitualmente, requieren el conocimiento de la forma de la distribución del tiempo de vida. En la Tabla 5.1 se comparan algunas de las principales características de los planes por atributos y por variables para porcentajes defectuosos.

Tabla 5.1 Comparación de planes de muestreo por atributos y por variables, para porcentajes de unidades defectuosas

Característica	Atributos	Variables
Inspección	Cada pieza se clasifica como	Se mide cada una de las
	defectuosa o no defectuosa. Se	piezas. La inspección es más
	pueden emplear calibres	compleja. Los costes de
	< <pasa -="" no="" pasa="">></pasa>	inspección y de administración
		son más elevados
Distribución de las medidas	No hace falta conocerla	Debe ser conocida (por lo
indıviduales		general se supone que es
		normal)
Tipo de defecto	Con un plan pueden valorarse	Se requiere un plan diferente
	defectos de todo tipo	para cada tipo de defecto
Tamaño de la muestra	Depende de la protección	El tamaño de la muestra es
	requenda	menor para una protección
		igual a la suministrada por el
		plan por atributos (por lo menos
		un 30 por 100 menor)
Información sobre el proceso	Porcentaje defectuoso	Porcentaje defectuoso, más
		información valiosa acerca de
		la media del proceso y su
		variabilidad para la aplicación
		de medidas correctivas
Severidad	Pondera de la misma forma	Pondera cada unidad
	todas las unidades defectuosas	ensamblada según su
	de una clase determinada	proximidad a las
		especificaciones
Evidencia para el proveedor	Son de indudable evidencia las	Es posible rechazar un lore
· · ·	unidades defectuosas de que	aunque la muestra no contenga
	se dispone	unidades defectuosas
Errores de medición	No se registran las mediciones	Mediciones disponibles para
		revisión
Lotes cribados	No afectan al funcionamiento	Pueden rechazarse por error
	del pian	lotes cribados, aunque no
		contengan unidades
		defectuosas

V.2 MIL-STD-105-D.

Las MIL-STD-105 se publicaron por primera vez en 1950 como MIL-STD-105A. La edición actual, MIL-STD-105D (1963), que apareció el 29 de abril de 1963, ofrece muchas mejoras importantes con respecto a las condicionas anteriores y nos ocuparemos sólo de ella. Pabst (1963) describe sus aspectos teóricos y sus características El lector interesado en este tema, así como en la comparación de la edición D con aspectos importantes de las ediciones anteriores, deberá estudiar esta referencia.

En las MIL-STD-105D, y en su versión civil ANSI/ASQC Z1.4 (1981), el índice de calidad es el nivel de calidad aceptable (NCA):

Se puede elegir entre 26 valores de NCA disponibles, comprendidos entre 0,010 y 1000,0. (Los valores iguales o inferiores a 10,0 pueden interpretarse como el porcentaje de unidades defectuosas o de defectos por cada cien unidades. Los valores supenores a 10,0 deben interpretarse como defectos por cada cien unidades.)

La probabilidad de aceptar una calidad NCA vana entre 89 y 99,5 por 100 . Los defectos se clasifican en críticos, mayores y menores.

El comprador puede, opcionalmente, especificar diferentes NCA para cada una de esas clases, o especificar un NCA para los distintos tipos de defectos que puede presentar un producto.

El comprador puede especificar también la magnitud relativa de la inspección o el nivel de inspección que debe aplicarse. Para las aplicaciones generales hay tres niveles, y el nivel II se considera como normal. La magnitud de la inspección necesaria para los tres niveles esta aproximadamente en la proporción 1 a 2,5 y a 4. Por lo general, se suele usar el nivel II, a menos que, debido a factores tales como la simplicidad y costo del producto, el costo de inspección, la destructividad

de la inspección, la calidad, la uniformidad entre lotes u otros factores, resulte más apropiado utilizar otro nivel. Las normas contienen también procedimientos especiales para la <<inspección de pequeñas muestras>> cuando es conveniente o necesario emplear muestras de tamaño reducido debido a ciertos aspectos de la inspección. En estos procedimientos especiales se incluyen cuatro niveles de inspección adicionales (S1 a S4).

A continuación, se resume el procedimiento a seguir para elegir el plan a partir de las tablas.

- 1. Hay que disponer de la siguiente información:
 - a. Nivel de calidad aceptable.
 - b. Tamaño del lote.
 - c. Tipo de muestreo (simple, doble o múltiple).
 - d. Nivel de inspección (por lo general, el nivel II).
- Conociendo el tamaño del lote y el nivel de inspección, se obtiene una letra de código a partir de la Tabla (5.2)
- Conociendo la letra de código, el NCA y el tipo de muestreo, se lee el plan de muestreo en una de las tablas maestras (Tabla 5.3 para una inspección normal con muestreo simple; las normas contienen también tablas para muestreo goble y múltiple).

Supongamos, por ejemplo, que un servicio de compras ha contratado un NCA del 1 por 100 para una determinada característica. Supongamos también que las piezas se compran en lotes de 1,500 unidades. En la tabla de letras de código según el tamaño de la muestra (Tabla 5.2) se indica que se requieren planes correspondientes a la letra K, para un nivel de inspección 11, que es el que se utiliza normalmente. Entonces, el plan que inicialmente, se ha de emplear, se busca en la fila K de la Tabla 5.3. El tamaño de la muestra es 125. Para un NCA

igual a 1,0, corresponde un número de aceptación igual a 3 y un número de rechazo igual a 4. Esto significa que puede aceptarse todo el lote de 1,500 unidades si se encuentran 3 o menos unidades defectuosas en la muestra de 125, pero que debe rechazarse si se encuentran 4 o más. Cuando el NCA se expresa como <<defectos por cada cien unidades>>, esta expresión puede sustituir a la de <unidades defectuosas>>. Hay también tablas para los casos de inspección intensa y reducida.

TABLA 5.2 Letras de código para cada tamaño de muestra

Tamaño del le	ote o nartida	Miveles d	le inspección ge	nerales
S OTESTICAL ACTOR IN	ore o parada	Ĵ	ĴÛ.	î81
2 a	8	Α	Α	В
9 a	15	Α	В	С
16 a	25	В	c	Q
26 a	50	С	ם	E
51 æ	90	c	E	F
91 a	150	D	F	G
151 a	280	E	G	Н
281 a	500	F	Н	J
501 a	1 200	G	j	K
1 201 a	3 200	H	K	L
3 201 a	10 000	J	L	М
10 0 0 1 a	35 000	К	М	N
35 001 a	150 000	<u>.</u>	N	Р
150 001 a	500 000	M	P	Q
500 00	i 1 ó más	N	Q	R

Las letras de código que muestra la tabla pueden aplicarse cuando se van a usar los niveles de inspección indicados. Las normas incluyen una tabla adicional de letras de código para la inspección con muestras pequeñas.

El método de elección del plan de muestreo inicial tiene en cuenta la calidad del producto realmente suministrada, sólo en el sentido limitado de que se considera alcanzable el NCA. Cuando el material que se envía posteriormente es, en general, de mejor calidad, las funciones de la inspección sobre las que se hace hincapié son algo diferentes de las que se aplican cuando el material suele ser peor Si la calidad media es alta, el muestreo proporciona información sobre el nivel de calidad preponderante y ofrece cierta seguridad de que se detectara cualquier deterioro repentino de la calidad, rechazándose los lotes de baja calidad. Las funciones de separar los lotes buenos de los maios y de presionar para que el proveedor mejore la calidad son menos importantes. Además, el material maio o de calidad dudosa se envía raramente a la inspección (ya que el fabricante lo suele detectar en su propia inspección), por lo que sólo se justifica, desde el punto de vista económico, una inspección de relativa pequeña magnitud.

Si la calidad del producto enviado es uniformemente baja, se rechazara la mayor parte de los lotes. Por otro lado, es triste pero cierto que los pocos lotes examinados y aceptados en estas circunstancias no serán considerablemente mejores que los rechazados. Si el NCA se eligió convenientemente y esta al alcance de este o de otros proveedores, resulta necesario presionar con mas fuerza para lograr que el proveedor alcance esta calidad. Además, el muestreo requiere poder discriminar con mas claridad entre el material bueno y el malo a fin de reducir el riesgo del comprador. Por todo esto, las MIL-STD-105D ofrecen dos vanantes en cuanto a severidad del muestreo, además de la norma, lo que permite sejeccionar también una inspección reducida o intensa.

配給配。 8.3 ,14 Lobla maestra de tas Mil. STD-105D para la inspección normal (muestreo simple)

Country Coun				= 4 4
1,0,0,0 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0		[콜	ا <u>×</u> ا پد	# # \
1,0,0,0 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0		हें	જેં	2 F F (\
Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Service de la			ا مُد	
Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Service de la		毒	7	Z 5 2 V
Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Real maser Numeric de calidad aceptable (majerción normal) Service de la		3	뇶	
Principle 10 1 1 1 1 1 1 1 1		·	77	~ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Principle 10 1 1 1 1 1 1 1 1		3	ي	- 2 = 2
Principle 10 1 1 1 1 1 1 1 1		Ē	3	* = * = * = * = * = * = * = * = * = * =
Principle 10 1 1 1 1 1 1 1 1			<i>=</i>	7 5 8 E 2 31 /L
Principle 10 1 1 1 1 1 1 1 1		_	Æ	=
Nucles de calidad aceptable (inspección normal) Nucles de calidad aceptable (inspección norm		2	74	
Nivelex de calidad a ceptable (inspección hurmal)			ž	
Company Comp				
Company Comp		<u>*</u>	7	9-01-0-12=
Company Comp	mat)	2	2	
American	Dot	<u> </u>		
American	Ción	<u> </u>	7	
American). V	÷	् <u>ड</u> . स्	
American	3	41	æ	
Company Comp	bta			1-62 22 - 23 6
Company Comp	1 1	-	۳	V = VV = = =
Company Comp	alıda	<u> </u>	المج	
Company Comp	gec		ž	
Company Comp	<u> </u>	-	1 2	\ \ - \L \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
distributions of the second of	٤	F .	34	> P9 = =
distributions of the second of		. ¥.	*	
distributions of the second of			 	- (-)
distributions of the second of		=	-	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -
distributions of the second of			÷	<u> </u>
distributions of the second of			1 2	
distributions of the second of			<u>. ~</u>	
distributions of the second of	į	100	=	
distributions of the second of		0,025	ř	
distributions of the second of		. E	, ž	
della		=======================================	- - -	
1 3 4 8				
conject of the conjec	lamak	de la		TT TENER (34) X 8 4 9
	kins ite codigo	un Xax	MORNIA.	7 m - 2 3 m - 2 - 7 - 5 - 4

Esse d'ammen plan de massèrec delange de la flecha. Se el tourence de la macatra spand o mayor una el decline, o parteta, redizar una major al religion (40).

Usar al pama plan Ac muestre commission al Gaba

4 4 4

Numero de aceptacion - Namem de rectorio

V.3 APLICACIÓN DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR ATRIBUTOS:

Hacemos referencia a la especificación de una materia prima en especial que es Cartulina K-1(2K), donde nos hace referencia a unos datos que nos determina el muestreo.

- Determina defectos críticos.
- Determina el N A C = 2.5
- Especifica los requenmientos

El material antes mencionado en los últimos lotes presenta en su cara antenor manchas negras que para efecto de tipificarlas le llamamos repinte, esto causa mala apariencia.

Los lotes son vanados por tanto tomaremos uno de una cantidad de 650,000 pzas, utilizando los criterios ante mencionados se checará si cumple con la especificación.

Lote:650,000 pzas.

N C A 2.5

NIVEL II Aunque la especificación no lo marca es el que se usa para este material. Es el más recomendado en la literatura.

Muestreo inspección normal.

- se determina la letra código con la tabla 5.2 con un lote de 650,000 y un NIVEL
 Il letra código Q.
- con la letra código Q, el N C A y su inspección normal determinados el tamaño de muestra el número de piezas con la cual aceptamos el lote o lo rechazamos según tabla 5.3

tamaño de muestra 1250

aceptamos 21 pzas.

rechazamos 22 pzas.

al checar el material de pasa o no pasa el repinte el número de plezas rebasó por mucho el parámetro de 22 pzas, por tal motivo el lote se rechazó.

V.6 PROCEDIMIENTOS DE ACEPTACIÓN POR CARACTERÍSTICAS VARIABLES

Denominamos características variables a aquellas que pueden ser medidas. Son ejemplos las longitudes, pesos, diámetros, etc. Desde un punto de vista matemático, puede decirse que es posible representar las características variables por números reales, en tanto que las esenciales, atributos, sólo se pueden representar por medio de números enteros. Para mejor comprensión podríamos decir que una longitud (característica variable) se puede representar por medio de un número decimal o fraccionario, como 8,17 cm., en tanto que el número de artículos defectuosos en un lote sólo puede ser un número entero por tratarse de una característica esencial, de un atributo, por ejemplo, 3 ó 4. los gráficos X de control de procesos se ocupan de características variables. Los procedimientos de aceptación para características variables pueden diseñarse en forma de *Plan* de *muestreo de variables*.

V.5 APLICACION DEL MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR VARIABLES

Las condiciones que normalmente permiten la aplicación del muestreo de vanables para aceptación son las siguientes:

- La característica objeto de inspección debe ser una variable o capaz de ser convertida según una escala vanable.
- 2 La inspección de atributos o características esenciales resulta excesivamente costosa (tiempo de inspección, naturaleza destructiva de las pruebas, etc.).
- 3 La inspección de atributos no proporcionará suficiente información; esto es, también se requieren el alcance y las consecuencias de la variación.
- La distribución de las características debe de ser aproximadamente normal

Las características distintivas de un plan de muestreo de variables, en comparación con un plan de atributos, son los siguientes.

- Se obtiene una protección análoga con una muestra de menor tamaño.
- Sólo puede aplicarse para la aceptación o rechazo de una característica sometida à inspección.
- 3 Implica, en general, mayores costos administrativos. Se precisan mejores cualificaciones, más cálculos, es posible cometer mayor cantidad de errores de cálculo y se hace preciso utilizar equipo de inspección más caro.
- Suele proporcionar mejores fundamentos para mejorar la calidad y mucha más información en casos de renuncia.

v.6 Plan de muestreo de variables

Supongamos que n es el número de elementos de una muestra y x_i , i = 1, 2 ..., n, los valores obtenidos para la característica variable. Supongamos que la distribución de probabilidad de x_i sea constante y con una media y y una varianza G^2 .

Teniendo en cuenta el teorema del límite central, veremos que la distribución aproximada de la media de la muestra será.

que es normal con la media $\mbox{$\mathbb{L}$}$ y la vananza (1/n) $\mbox{$\mathbb{C}2 . al igual que en los casos de gráficos $\mbox{$\overline{X}$}$ de control de procesos, cuando no se conozcan los valores reales de los parámetros $\mbox{$\mathbb{L}$}$ y $\mbox{$\mathbb{C}2 , pueden obtenerse estimaciones aceptables de las mismas muestras Estas estimaciones son:

estimado de 🎉 = X = media de las medias de la muestra

estimado de $\mathbb{C}=0$ bien \overline{s} , desviación estándar de la muestra, o bien \overline{R}/d_2 , como se utilizan en los gráficos \overline{X} y R

Si la característica está sujeta a un límite superior U, el porcentaje de elementos inaceptables del lote (aquellos que superan el límite superior) aparece marcada en la zona rayada p_u de la figura 5.1, si la curva de la figura 5.1 fuera la distribución exacta de X, p_u será exactamente la fracción defectuosa del lote.

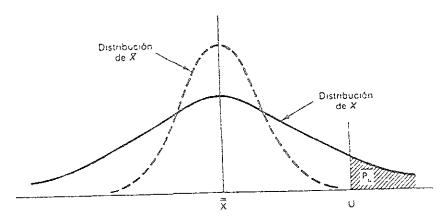


Figura 5.1 Prebabilidad de aceptación de un lote.

Cuando la curva es únicamente una estimación basada en las observaciones realizadas sobre la muestra, p_u es también una estimación. El criterio para la aceptación del lote es que p_u debe ser igual o menor que un número establecido M, un plan de muestra de vanables se especifica por medio de dos números: n = tamaño de la muestra y M = máximo permisible para la fracción defectuosa.

Una medida alternativa de la fracción de elementos que son defectuosos es z, o, lo que es lo mismo, cuántas desviaciones estándar estimadas separan el límite U de las especificaciones del promedio de la muestra \overline{X} :

$$z = \frac{U - \overline{X}}{G}$$

Esto nos permite formular una definición alternativa del plan de muestreo de variables mediante los números n= tamaño de la muestra, y k= mínimo de desviaciones estándar que deben separar U y \overline{X} .

V.7 Operación de un plan de muestreo de variables

La operación de un pian de muestreo de variables supone recorrer los siguientes pasos:

- 1 Establecer el plan de muestreo según la forma 1 (n, k) o la 2 (n, M). Los términos forma 1 y 2 son los que se utilizan en las tablas de estándares militares, que suelen utilizarse en estos planes de muestreo
- Tomar una muestra de tamaño n del lote y medir las características vanables de cada elemento
- 3. Determinar X y z o p_u . El procedimiento de cálculo se muestra en el ejemplo numérico que sigue.
- 4. Aceptar si el lote es $z \ge k$ o si $p_u \le M$. En caso contrano habrá que rechazarlo.

Cuando existen límites de especificación, tanto superior como inferior, los criterios de aceptación se modifican del modo siguiente:

- 1. En la forma 1 ambos $(U \overline{X})/C$ y $(\overline{X} L)/C$ depen ser mayores que k.
- En la forma 2 se calculan valores separados de p_u y p_1 . La suma $o_u + p_1$ debe ser menor que M.

V.8 MIL-STD-414

Aunque hay muchas fuentes autorizadas de planes de muestreo de aceptación por variables, sólo nos referimos detalladamente en este capitulo a MIL-STD 414. Lo mismo que MIL-STD-105D, este documento se ha convertido en norma tanto para la industria privada como para el gobierno. MIL-STD-414 tiene cuatro secciones: A, B, C Y D.

La sección A incluye una descripción general de los planes de muestreo. Establece medidas para el uso de los planes, para la clasificación de los defectos, la expresión de no conformidad, el nivel de calidad aceptable(AQL), presentación del producto, aceptabilidad de lotes, selección de muestras, cálculo de la calidad media, cambios en la severidad de la inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes mixtos de muestreo por atributos y variables.

La sección B incluye instrucciones para aplicación de planes de desviación estándar C desconocida para límites de especificación únicos y dobles; tablas maestras para inspección normal, rigurosa y reducida; para el calculo del porcentaje de elementos defectuosos de lote usado el método de la desviación estándar, instrucciones y tablas para el cálculo de la calidad media; criterios para inspección reducida y rigurosa; valores de F para MSD (desviación estándar máxima); y ejemplos de cálculos. Estos aparecen en las tablas A5 4 a A5 19.

Las tablas 5.6 y 5.7 a 5.14 se usan para buscar planes de muestreo cuando hay presentes especificaciones de doble límite. El cálculo es el mismo que para la forma 2 excepto en lo siguiente:

1. Para un valor de AQL para los límites superior e inferior de las especificaciones combinados, se calculan tanto Q_u como Q_L. El porcentaje estimado de elementos defectuosos por lote asociados a los ya calculados Q_U y Q_L se busca en la tabla 5.7.La suma de Pu ÷ P_L (que son los valores que acabamos de encontrar en la tabla) debe ser menor que livi para que el lote sea aceptable.

- 2. Para diferentes valores AQL para los límites superior e inferior de las especificaciones, se utilizan los tres criterios siguientes:
- a) Pu debe ser igual o menor que Mu.
- b) Pi deben ser igual o menor que Mi.
- c) $P_U + P_L$ debe ser igual o menor que el menor que el mayor entre M_U y M_L .

La forma 1 puede usarse también para el caso de límite de dos lados. Las cantidades (U-X)/s y (X-L)/s se comparan con k y deben ser mayores que k para que el lote sea aceptable. Además, el valor apropiado de F se busca en la TABLA 5.19 Para determinar la desviación estándar máxima (MSD). MSD se calcula hallando el producto de F y (U – L). La desviación estándar así calculada no debe ser mayor que MSD.

La sección C es aplicable al caso de variabilidad desconocida y es exactamente lo mismo que la sección B, excepto que las tablas se basan en cálculos usando el intervalo medio como medida de la variabilidad. Se usan lo mismo que indicaba la sección B a la que acabamos de referimos

La sección D es aplicable a una situación de variabilidad conocida y se organiza lo mismo que las secciones B Y C con las siguientes excepciones.

- La variabilidad es conocida, de forma que no se calcula a partir de los datos de la muestra.
- Para el método de la forma 2 del limite único y para el método del índice de calidad de límite doble, las fórmulas para los índices cualitativos son:

$$Q_{u} = \frac{(U - \overline{X})}{G}$$

$$y = \frac{(\overline{X} - L)}{G}$$

$$Q_{L} = \frac{(\overline{X} - L)}{G}$$

ଦ En que ଦ es la desviación estándar conocida. Las tablas se usan como se indicó en la sección B cuando se prescriben planes de variabilidad conocida. No se muestran tablas de las secciones C Y D Cualquier persona que usar dichas secciones puede ir al estándar onginal. No hay que dejar de mencionar que un índice de calidad calculado debe ser igual o mayor que el valor de k. Cualquier índice de calidad negativo es algebraicamente menor que el positivo de k y ello hace que el lote no sea aceptable.

Para resumir lo antenor presentamos la Tabla.- 5.20

Tabla. - 5.20 Aplicación de las MIL-STD-414 (1957) y ANSI/ASQC Z1 9 (1980)

Paso	Sección	Forms 1	Fоrma 2
Preparatorio		Obtener k y n a partir de las tablas correspondientes	Obtener <i>M</i> y <i>n</i> a partir de las tablas correspondientes
Determinar los criterios	Section B	$T_t = \frac{U - \overline{X}}{s}$	$Q_{k} = \frac{U - \overline{X}}{\varsigma}$
		$T_L = \frac{\overline{X} - L}{5}$	$Q_L = \frac{\overline{X} - L}{s}$
	Section C	$T_{\mathcal{L}} = \frac{\mathcal{L}' - \overline{X}}{\overline{R}}$	$Q_{t} = \frac{(U - \vec{X})c}{\overline{R}}$
	***************************************	$T_L = \frac{\overline{X} - L}{\overline{R}}$	$Q_L = \frac{(\overline{X} - L)\epsilon}{\overline{R}}$
	Section D (σ)	$T_{\ell} = \frac{U - \overline{X}}{\sigma}$	$Q_{\mathcal{L}} = \frac{(\mathcal{L} - \overline{X})v}{\sigma}$
		$T_L = \frac{\overline{X} - L}{\sigma}$	$Q_L = \frac{(\overline{X} - L)v}{\sigma}$
Estimacion			Entrar en la tabla con y Q_L o Q_L para obtener p_L o p_L
Accion	Especificación unica	Aceptar si $T_{\ell} \geqslant k$ o $T_{\ell} \geqslant k$	Aceptar si $p_t \leqslant M \circ p_L \leqslant M$
	Especificacion doble	Aceptar si ^{σ} $T_{\ell} \ge k$, $T_{\ell} \ge k$ $y \le C$ $S < DTM$ $S < RMA$	Aceptar si $p_L + p_L \leq M$

c = factor de escala

$$y = \sqrt{\frac{\eta}{\eta - 1}}$$

Fuente, E.G. Schilling, «Variables Sampling and MIL-STD-414», Fransactions of Twenty-stylt Quae-Control Conference of the Rochester Society for Quality Control. 30 marzo 1970, pages. 175-188 * No es el procedimiento oficial.

V.9 APLICACIÓN DEL MUESTREO POR VARIABLES.

Haciendo referencia a la especificación de la cartulina K-1(2K) se recopilan los datos de la característica de longitud total donde los resultados de su medida y su varianza fue la siguiente X =179.58, © =8.194 ¿Se debe aceptar este lote?

De la hoja de especificación

Longitud total: 180 ± 0.5mm

NCA: 2.5

INSPECCION NORMAL

SE RECIBE UN LOTE DE 450,000 PZAS.

- 1- Determinar la letra código con tabla 5.4 MIL-Stad 414 con tamaño de lote nivel de inspección IV MIL-414 código p
- 2- A partir de la letra de código y de NCA (tabla 5 6 solamente para las MIL STAD 414) tamaño muestra 150 valor de M = 4.43.
- 3- Calcular

$$Qu = \frac{U - X (v)}{C} = \frac{180.5 - 179.58 (1.003)}{0.194} = 4.75$$

$$X - L (\forall)$$
 179.58 - 179.5 (1.003)
 $QL = \frac{}{} = \frac{}{} = 0.413$

$$v = \sqrt{\frac{n}{n-1}}$$
 $v = \sqrt{\frac{150}{150-1}}$
 $v = 1003$

4- Estimar el porcentaje de unidades defectuosas a partir de la tabla 5 7 y 5.14 Especificación superior: estimar Pu% a partir de Qu y n.

$$Pu(\%) = .0003$$

Especificación infenor, estimar pl(%) a partir de Qu y n

Doble especificación: estima P(%) =

P%=34.11+0.003=34.113

Criterio de aceptación

Doble especificación:

P(%) < M

34 11 > 4.43

no se cumple el criterio de aceptación por tal motivo se rechaza el lote:

4- Estimar el porcentaje de unidades defectuosas a partir de la tabla 5.7 y 5.14 Especificación superior estimar Pu% a partir de Qu y n.

$$Pu(\%) = .0003$$

Especificación inferior, estimar pl(%) a partir de Qu y n

Doble especificación: estima P(%) =

P%=34.11+0.003=34.113

Criterio de aceptación

Doble especificación:

P(%) < M

34.11 > 4.43

no se cumple el criterio de aceptación por tal motivo se rechaza el lote:

CAPITULO VI PRUEBAS DE HIPÓTESIS EN POBLACIONES NORMALES

VI.1 PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA MEDIAS

En este capítulo, estudiaremos la metodología para llevar a cabo pruebas de hipótesis referentes al parámetro μ la medida de una población normal.

Consideramos casos en donde las varianzas poblacionales sea o no conocidas, y también el estudio comparativo de dos medidas poblacionales sea o no conocidas, también el estudio comparativo de dos medidas poblacionales.

En esta sección y en las siguientes, se manejará el estadístico de prueba en su forma estándar. Es decir, por ejemplo, si el estadístico asociado a nuestro experimento es " " (la medida muestral), éste será estandarizado, ya sea a un variable normal estándar (z), en el caso de que se conozca la desviación estándar poblacional, o a una variable t de Studen, en caso contrario.

La finalidad de esta estandarización es de facilitar el procedimiento de decisión en la prueba. Las ideas anteriores se ilustran a continuación.

VI.2 PRUEBA DE HIPOTESIS PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMAL CON VARIANZA CONOCIDA

Consideramos una población normal, cuya medida es desconocida y su varianza "
" es conocida (Si la población no es normal, supongamos que se cumplen las condiciones del Teorema Central del Limite). Deseamos propar la hipótesis nula:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Con la letra

$$H_1: \mu = \mu_0$$

Donde 40 es una constante.

Para esto, tomamos una muestra aleatoria de n observaciones independientes de esta población X1, X2, Xn formamos luego el estadístico de prueba.

Que tiene distribución normal estándar, si la hipotenusa es verdadera. Así la probabilidad de que Z tome un valor entre $-Z\alpha$ /2 Y $Z\alpha$ /2 es 1 - α : esto se ilustra en la figura 6.1:

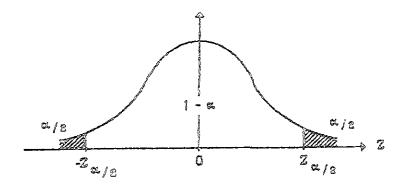


Figura 6.1 Región de rechazo H_0 : $\mu = \mu o$ en un ensayo bilateral

Esto es, probabilidad de que el valor de Z se encuentra en la región $Z > Z \propto /2$ o $Z < Z \propto /2$, cuando la hipótesis nula es verdadera, es α :

Si seleccionamos un valor de a pequeño, sabemos que es poco probable que el valor de Z se encuentre en las colas de esta distribución, y si esto ocurre, puede ser un indico de la falsedad de la hipótesis nula. Por todo esto, decimos que

Forman la región de rechazo para prueba Es decir, rechazaremos la hipótesis nula si el valor del estadístico de prueba se encuentra en cualquiera de estas dos regiones. La probabilidad de estar equivocados (cometer error 1) es a

Las pruebas de este estilo, en donde la región de rechazo se encuentra en las colas de cierta distribución, se denominan pruebas de dos colas.

Supongamos ahora que deseamos probar la alternativa unilateral

$$H_1: \mu = \mu 0$$

Recordando que el estadístico de prueba es

$$Z = \frac{X - \mu o}{C / n}$$

Concluimos que valores negativos de Z no flevarían al rechazo de Ho. Es decir, la región de rechazo en esta prueba está en la cola derecha de la distribución normal estándar (fig. 6.2)

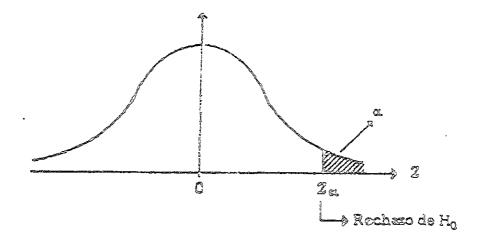


Fig. 6.2 región de rechazo de Ho $\mu = \mu_0$, es un ensayo unilateral

Debemos entonces rechazar Ho sí

 $Z > Z_{Cz}$

En forma similar, si deseamos probar

 $H_0: \mu < \mu_0$

Debe calcular el estadístico de prueba Z, y rechazaremos la hipótesis nula si el valor de Z se encuentra en la cola izquierda de la distribución normal estándar es decir. sí:

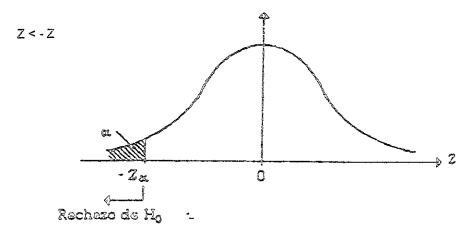


Fig. 6.3 región de rechazo de H_0 : $\mu = \mu o$, en un ensayo bilateral

VI.3 APLICACIÓN DE PRUEBA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS.

Se ha notado en los últimos meses una disminución en la cantidad de piezas de blister en la presentación de 40g la forma de confirmar lo que el proveedor dice es pensado las cajas del material que llegan cada vez que llega un lote. El proveedor afirma que el peso por caja es de 3862g una muestra de 6 cajas arrojo un promedio en peso de 3,608 g. con una desviación estándar de 192.9 g.

Con esta información se puede concluir que el proveedor esta surtiendo este material con menor peso y por ende utilizar un nivel de significancia $\alpha=0.05$

Postular la hipótasis como sigue.

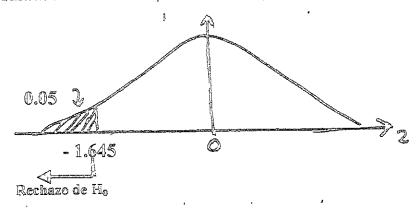
Ho: $\mu = 3862$

H1: µ < 3862

La información muestral es n = 6, \overline{X} = 3608, por lo que el estadístico de prueba es:

$$Z = \frac{X - \mu_0}{G / \sqrt{n}} = \frac{3608 - 3862}{192.9} = \frac{-254}{192.9} = \frac{-3.21}{79.05}$$

La región de rechazo de lote está por Z < -0.05 utilizando la tabla de la distribución normal encontramos que Z 0.05 = 1.645 para un ensayo unitateral.



El valor de z se encuentra en la región de rechazo, por lo que concluimos que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula.

Por lo tanto el proveedor si esta enviando cajas con menor peso y por lo tanto con menos piezas.

VII.1 PROPUESTAS

La forma de presentar las herramientas estadísticas para resolver problemas de calidad no es necesariamente el orden y además se habló que en un porcentaje alto que es el de 80% resuelve los mismos, aunque lo que más resalta es el signo de pesos \$, esto significa un costo de una pobre calidad y el objetivo de la forma de presentación de las herramientas por experiencia es cuantificar la importancia del problema en un lenguaje que impacte a la alta dirección.

El lenguaje del dinero mejora la comunicación entre la dirección intermedia y la aita dirección. En algunas empresas, la necesidad de mejorar las comunicaciones cuando se tratan materias relacionadas con la calidad a sido tan acusada que ha llegado a ser uno de los principales objetivos para iniciar el estudio de los costos de una pobre calidad.

Algunos directivos dicen "nosotros no necesitamos gastar tiempo en traducir los defectos en dinero, comprendemos que la calidad es importante y ya sabremos cuales son los problemas principales. Normalmente, cuando se hace el estudio estos directivos se sorprenden en dos resultados. Primero los costos de la calidad resultan ser mucho mayores de lo que creían. En muchas industrias exceden el 20% de las ventas. Segundo, aunque la distribución de los costos de calidad confirman algunas de las áreas con problemas conocidos, también descubren otras con problemas que previamente no habían sido identificados.

Por lo tanto una forma de convencer a la alta dirección que el gasto en la calidad no es precisamente un costo que no se recupera sino una inversión que a conto o largo plazo traerá mucho más beneficios que no solo serán económicos sino que el más importante es la permanencia en el mercado.

BIBLIOGRAFIA:

MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD

J.M. JURAN

FRANK, MC GRAWHILL.

ADMINISTRACIÓN DE LOCALIDAD TOTAL PARA INGENIEROS ZAIIRI ED. PANORAMA.

INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y ESTADISTICA WILLIAM MENDELHALL.
GRUPO EDITORIAL IBEROAMERICA.

ESTADISTICA PARA INGENIEROS
A. H. BOWKER G J. LIEBERMAN.
PRETINCE HALL
ED. IBEROAMERICAN.

CONTROL DE CALIDAD
TEORIA Y APLICACIONES.
BERTRAND L. HENSEN
PRABHAKAR M. GHARE.
EDICIONES DIAZ DESANTOS, S.A.

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA GEORGE C. CANAVOS EDITORIAL MC. GRAW HILL

ESTADÍSTICA E INVESTIGACION DE OPERACIONES KALESH MASUR DA EL SALON EDITORIAL PRENTICE HILL

CALIDAD TOTAL
CARLOS GONZALEZ
Mc. GRAW HILL

NMX – CC – 001: 1995 IMNC ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, VOCABULARIO

esta tesis no sali de la biblioteca

APÉNDICE

- > HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA CARTULINA
- ➢ GRAFICA DE CONTROL POR ATRIBUTOS
- ➢ GRAFICA DE CONTROL POR VARIABLES
- > GRAFICAS MIL STD 414 (DE LA 5.5 A LA 5.19)
- > TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL





Emisión No. 4 2CARTK12K-1

ESPECIPICACIÓN DE MATERIA PRIMA

descripción:

CARTULINA K-1 (2K)

va. DB Parte:

PROVEEDOR:

2.5 NOM Z-12

2CARTK12K-1

MUESTREO:

VAC:

SENCILLO INSPECCIÓN NORMAL.

MATERIAL:

CARTÓN DE 18 PUNTOS REVERSO BLANCO PONDEROSA.

reso:

5.4 g ± 0.3 g

COLOR:

PANTONES: ROJO 186 C, VERDE 355 T NEGRO

ACABADO:

IMPRESIÓN A 3 TINTAS Y CON BARNIZ TERMOSELLANTE BASE AGUA PARA PVC.

DIMENSIONES:	SEGUN DIBUJO) No. 12- A	
CARACTERÍSTICAS		DIMENSIÓN	TOLBRANCIA
(BÁSICAS)		(mm)	(mm)
PLONGITUD TOTAL		180.0	<u>≁</u> €3
*ANCHO TOTAL		85.D	± 0.5
ESPESOR		0.45	± 0 025
CEJA LATERAL		2.5	± 05
CEJA INFERIOR		4.5	<u>*</u> 05
*ALTURA DE "CONTENIDO NE	TO 2g "	¢, 0	+ 0 5 - 0

NOTA:

1.- CONSIDERAR LAS DIMENSIONES MARCADAS (°) COMO CRITICAS PARA SU

FABRICACIÓN.

l USO:

PRESENTACIÓN DE 23 DE K-1 COMO PRODUCTO TERMINADO.

2. PRESENTACIÓN:

CAJAS CORRUGADAS CONTENIENDO 4,200 PIEZAS, ACOMODADAS SOBRE CUALQUIER CANTO LONGITU DINAL SIGUIEN DO EL MISMO SENTIDO Y EL MISMO ACOMO DO, EN 2 NIVELES MÁXIMO.

, 3<u>,</u> 3,

A.- LAS ESQUINAS SERÁN REDONDEADAS CON UN RADIO DE CURVATURA DE 8 mm TLIBRE DE REBABA.

B.- EN LA CARA FRONTAL, EN EL ANGULO SUPERIOR ZQUIERDO DEBERÁ TENER UNA PERFORACIÓN, SEGÚN DIBUJO, EXENTA DE REBABA.



DESPUÉS SE OBSERVA SI EN LA PARTE DESPRENDIDA EXSTE CAOLÍN, PARA SER APROBATORIA LA PRUEBA DEBERÁ EXISTIR COMO MÍNIMO UN 80 % DE CAOLÍN ANCLADO.

5. ALMACENAJE: CAJAS DE CARTÓN COMPLETAS Y CERRADAS, PROTEGIÉNDOLAS DE

MALTRATO Y CONTAMINACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA DE ESTIBA SERA DE 6 CAMAS.

7. DEFECTOS: CRÍTICOS.-

A) SUAJADO DESCENTRADO. B) FALTA DE ANCLAJE.

C) PUNTOS O MANCHAS BLANCAS O DE TINTA.

D) ESCURRIMIENTO DE TINTA.

E) COLOR FUERA DE ESPECIFICACIÓN.

e. condiciones de operación:

LA CARTULINA DEBERÁ SELLAR ENTRE 150°C Y 170°C, Y 3 SEG. DE TIEMPO. BAJO UNA PRESIÓN DE 6 A 8 BAR.

9. CÓDIGO DE BARRAS: 7 501102 510006 (2K)

10. EQUIPO PARA MEDIR V COMPARAR:

MICRÓMETRO DE EXTERIORES, QUÍA PANTONE, LUPA DE BOLSILLO 10 X CON PLANTILLA 183-106 MITUTOYO, REGLA LITOGRÁFICA., BLISTEADORA.

NOTAS:

 PARA TO DA IMPRESIÓN Y PARA LOS AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SUFRA LA CARTULINA, SE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN A PIE DE MAQUINA POR LAS ÁREAS DE COMPRAS, MERCADOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD DE ESTA EMPRESA.

3. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON CADA LOTE DE MATERIAL ENTREGADO UN CERTIFICADO DE CALIDAD, EL CUAL GARANTIZARA QUE EL MATERIAL ENTREGADO A BRAZI BOLA LORA SE AJUSTA A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS ESPECIFICADAS Y PASA TODAS LAS PRUEBAS INDICADAS EN ESTA ESPECIFICACIÓN.

AGION			(H P) - (1 P) - (H U)
TIPO DE EVALUACION		CONSTANTE DIFFRENTE	(1 P) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
JII.			8 8
FRECUENCIA		10	27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
NA FREC			32
MAGUINA		2	2 2
		ta.	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0.5		ptr.	
SOL POR ATRIBUT			
GRAFICA DE CONTROL POR ATRIBUTOS	CARACTERISTICA	ESP NOMINAL	
		LSE	
 		TEM CRITICO	
MOLA LOKA	ļ	TIPO DE CARTA	3. [31] <u>[10] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1</u>
Krash Krash	AREA		No DE COTE COTE COTE COTE COTE COTE COTE COT

No. FECHAS CARACTERISTICA FREC.	FREC,/TAMARO MUESTRA	אָבָּ עַנְ בַּאַנְאַנִייִבּ
LICE X-AZE	PROMEDIOS (CARTA X)	SOBRE CAUSAS ESPECIALES
PCM END DE A		CUALGUIER PUNTO FUERA DE
		"LOS LIVITES DE CONTROC.
		· UNA SERIE DE 7 PUNTOS ARRIBA
		O ABAJO DE LA LINEA CENTRAL
		I DNA TENDENCIA DU 7 INTERVA-
		LOS ASCENDENTES O DESCEN-
		DENTES.
		CUALQUIER OTRO PATRON QUE
		DEMUESTRE INESTABILIDAD
		ACCIONES
Ì		c
Ţ		,
: 		r
		¥,
LICED R	RANGOS (CARLA RI	
DIO DE H		,
1		۵
		SUBGRUPOS A ₂ 0 ₃ 0 ₄
		168 327
		3 102 257
		73 • 2,28
		6 49 • 2.00
		7 ,42 ,08 1,92
		98 1 21, 75, 8
,		
3		
		10 31 ,22 1.70
5		EL PROCESO DEBE ESTAR EN
		CONTROL ESTADISTICO ANTES
VAA	* ! !	DE OUE LA HABILIDAD PUEDA
ELECT		SER DETERMINADA
AAYOP		: ^
and del Producto	na el límite inferior de control para re	Ingos.
301 k		

MAD, No.

Olc 83

SUMA SUMA SUMA NOIDELLECT HENOR

ß

LECTURAS

4.

Of, de Calidad del Producto

TABLA A 5.4 Letras-código de temaño de muestra (Tabla A-2 del MIL-STD-414)

R		เกิด		Nivele	s de ir	ıspecci	ón
de	:1 10)le	Fa	11	111	IV	V
3	a	8	В	B	B	B	C
9	2	15	В	\mathbb{B}	B	\mathbb{B}	D
16	2	25	В	B	B	C	E
26	a	40	B	B	B	D	F
41	æ	65	В	B	C	E	G
66	a	110	В	B	D	F	H
111	2	180	B	C	E	G	I
181	a	300	B	D	<u> </u>	H	J
301	a	500	C	\mathbf{E}	\mathbb{G}	I	K
501	2	800	D	F	H	J	L
108	ୟ	1,300	E	G	Ï	K	L
1,301	a	3,200	F	H	j	L	M
3,201	2	8,000	\mathbb{G}]	Ĩ.	M	N
8,001	а	22,000	H	J	M	R	0
22,001	2	110,000	I	K	N	0	P .
110,001	2	550,000	I	K	0	P	Q
550,001	уо	îros	X	K	2	Q	Q

Las letras-código del tamaño de la muestra que figuran en la tabía se aplican cuando se usan los niveles de inspección indicados.

MOSA ARGO. Tabla maestra de inspección normal y rigurosa para planes basados en variabilidad desconocida (limite de especificación simple-forma 1), método de desviación estándar (Tabla B-1 del MIL-STD-414)

							- 1	. 1	_ 1	1
		15.00	-12	0.341	0.455	0.664 0.695 0.712	0.723	0.774 0.804 0.819	0.841	
The special property of		10.00	k	0.565	0.675 0.755 0.828	0.886 0.917 0.936	0.946 0.969 0.971	1.00	1.07	15.00
		6.50	le	0.765	0.874 0.955 1.03	1.09	1.15 1.18 1.18	1.21 1.24 1.26	1.29	10.00
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		8.90	22	0.958	1.07	1.30 1.33 1.35	1.38	1.42 1.46 1.48	1.51	6.50
and the second leading to the second leading	-	2.50	k	1.12	1.24	1.51	1.55 1.57 1.58	1.61 1.65 1.67	1.70	4.00
-	neu j	1.50	y.	1.34	1.50	1.65	1.73	1.80 1.84 1.86	1.89	2.50
	cion norn	1.00	R	1.45	1.53	1.79	1.85	1.93 1.98 2.00	2.03	1.50
	oadsut) at	0.65	24		1.65	1.91	2.03	2.08 2.12 2.14	2.18	1.00
	d aceptab	0.40	h		\$ 1.18 88.19 88.19	2.08	2.15 2.18 2.18	2.22 2.27 2.27 2.29	2,33	0.65
	Niveles de calidad aceptable (inspeccion normal)	0.25	k	_	2.00	2.20 2.24 2.26	2.28	2,35 2,41 2,43	2.47	0,40
	Niveles	0.15	k		2.23	2.32	2.45	2.50 2.55 2.58	2.61	0.25
		0.10	*	-		2.42	2.51	2.60	2.73	0.15
		0.065	34			2.53 2.58	2.65	2.71	2.84	01.0
		0.04	It			2.64	2.73	2.83	2.96	0.065
-			ño de			15 20 20	30 32	55 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	150	
100	,	Letra- código de	tamaño de la muestra	æ) O 215	- 0#		JZZ	٥١٥	

Todos los valores de AQL vienen dados en porcentaje de elementos defectuosos. Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha, esto es, tanto el tamaño de la muestra como el valor de h. Cuando el tamaño de la muestra es igual o mayor que el lamaño del lote, debe inspeccionarse cada uno de los elementos del lote.

Niveles de calidad aceptable (inspección rigurosa)

PAD Roll Tabla maestra de inspección normal y rigurosa para planes basados en variabilidad desconocida (Umite de especificación doble

[cira-						Niveles	Niveles de calidad	d accptab	de (inspec	aceptable (inspección normal)	(lei					
codigo de Lamaño de	maño mue:	70 0	0 065	0.10	0 15	0.25	0 40	0.65	1.00	1.50	2.50	4.00	6.50	10.00	15,00	
la muestra		×	M	Ж	M	М	M	M	Ħ	×	M	M	M	M	M	
ရာပ	ω <u>4</u>							>	1 53		7.59	18.96 16.45	26.94 22.86	33 69 29.45	40.47	
CB#	5 7 10	->) 	>	0.349	0 422 0.716	1.06 1.30	1.33 2.14 2.17	3.32 3.55 3.26	5.83 5.35 4.77	9.80 8.40 7.29	14.39 12.20 10.54	20.19 17.35 15.17	26.56 23.29 20.74	33.98 27.50 27.57	
OH-	15 20 25	0.099 0.135 0.155	0.186 0.228 0.250	0.312 0.365 0.360	0 503 0 544 0.551	0.818 0.846 0.877	1 23	2,11 2,05 2.00	3.05 2.95 2.86	4.31 4.09 3.97	6.56 6.17 5.97	9 46 8.92 8.63	13.71 12.99 12.57	18.94 18.03 17.51	25.61 24.53 23.97	
L K	98. 40. 40.	0 179 0 170 0.179	0.264 0.264 0.275	0.413 0.388 0.401	0.581 0.535 0.566	0.879 0.847 0.873	1.29	1.98 1.87 1.88	2.83	3.91 3.70 3.72	5,86 5,57 5,58	8.47 8.10 8.09	12.36 11.87 11.85	17.24 16.65 16.61	23.58 22.91 22.86	
ZZO	55 100	0.163 0.147 0.145	0 250 0.228 0.220	0.330 0.330 0.317	0.503 0.467 0.447	0.789 0.720 0.689	1.17	1.71 1.60 1.53	2.49 2.29 2.30	3.45 3.20 3.07	5.20 4.87 4.69	7.61 7.15 6.91	11.23 10.63 10.32	15.87 15.13 14.75	22.00 21.11 20.66	
20	150	0.134	0.203	0.293	0,413	0.638	0.949	1 43	2.05	2.89	4.43	6 57 6.53	9.88 9.81	14.20 14.12	20.02 19.92	
		0.065	0.10	0 15	0.25	0 40	0.65	1,00	1.50	2.50	4.00	6.50	10.00	15.00		

Niveles de calidad aceptable (inspección rigurosa) Forlos los valores de AQL vienen dados en porcentaje de elementos defectuosos.

Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha, esto es, tanto el tamaño de la muestra como el valor M. Cuando el tamaño de la muestra es sgual o mayor que el tamaño del lote, debe inspeccionarse cada uno de los elementos del lote

TABLA - 5.7 Tabla para el cálculo del porcentaje de elementos defectuosos del iote usando el método de la desviación estándar

Q _L or													Ta	ma	ño	de	1 1	o te													1
Q_{σ}	3	1	.	5		7	-	10	}	13	5	20		2	5	30	9	3	5	4(50		75		100		150	:	200	
1	37 3	050 2446 643	67	46	44	46	26	46.	16	46.	10	46.	08	46.	.osi	46	05	4¢.	.051	46	041	46 (14/4	6 ()3 -	6.0	34	6 0	12 4	6. o:	ρļ
.31	41.	53 10 35 39 36 39 77 39 19 38	67 33 00	38 38	02 67	38. 38. 37	50 14 78	38 37. 37	23 86 49	38 37. 37.	06i 69i 31	37 37. 37.	99 62 24	37 37 37	95 58. 20	37 37. 37	93 55 18	37. 37. 37.	91 54 16	37. 37. 37	90 52 15	37.3 37.3 37.	39(3 31(3 13(3	7 7 7	:73 :93 :13	7 8 37 4 37.1	86.3 1813 10.3	17.8 17.4 17.6	34/3 16/3 19/3	$\frac{7}{7}$ $\frac{8}{4}$	6
.36	39.1 39.1	2038 9138 6237 3337 0337	00. 67 ממ	37. 36.	28 93 58	36. 36 35	69 33 88	36. 36 35	38 02 65	36. 35. 35.	20 83 46	36. 35. 35	12 75 38	35 35 35	.08 71 34	36. 35 135	.05 68 31	36 35 35	.04 .66 .29	36. 35 35	.02 65 28	36. 35 35	01 63 26	35 : 35 : 35 :	981. 61. 24.	35 9 35 9 35 1	371. 501. 231.	35 S 35 S 35 S	96 3 5913 2213	\$.9 \$.5 \$.3	61 81
. 4] - - 3 4	(38. 238.	74 36 45 36 15 36 85 35 56 35	.00	35 35	.54 19	34 34. 34.	90 55 19	34 34 33	57 21 85	34 34 . 33	.37 .00	34 33 33	28 92 56	33 33 33	. 24 . 87 . 51	34 33 33	. 21 85 48	34 33 33	. 19 . 83 . 46	34 33 33	. 18 . 81 . 45	34. 33 33	161 794 43	34 33 33	130 770 40	34. 33 33	121 75. 391	34 33. 33	113 743 385	34.1 33.7 33.3	(0 14 37
. 46 47	36. 36 36	26,35 96,34 66,34 35,34 05,33	. 67 . 33 . 60	13 3 . 133 133	.81 47 12	33 32 32	13 78 43	32 32 32	.78 42 07	32. 32. 31	.57 .21 .85	32 32 31	. 48 . 12 . 77	132 132 131	. 43 . 07 . 72	32 32 31	. 4(.0. 69	ж32 µ32 Й31	.38 .02 .67	132 132 131	. 37 . 01 . 65	32 31. 31	35 99 53	32 31 31	321 96 611	32 31. 31	31 95, 60	32. 31 31	300 940 580	32 : 31 :9 31 :	29 93 58
.5 .5	135 235	75 33 44 33 13 32 82 32 51 32	.00.	32 31	10 76	131 131 130	39 04	31 30 30	02 67	30 30 30	80 45	430 30 430	71 3€. !∩!	(30 (30 (30	1 60 1 31 1 94	30 130 129	2	3130 3130 3129) 63) 26) 9	130 130 1129	1 60 1 25 1 90	30 30 29	23	30 30 29	204 83	30. 30. 129	19	30 30 29	33	30 : 30 29	52 11 51
5	633. 733 833	20/31 88/31 57/31 25/30 93/30	30	:[30 :30 :00	40 UF 71	29 29 328	57 37	7 29 3 28 3 28	29 95 61)29)28 !!!!8	07 73 39	128 128 128	98 54 3.34	3128 4128 0128	3 9: 3 5: 3 2:	3 28 9 29 5 28	} 9 }.5 }.2	0 28 6-28 2 28	3.8 3.5 3.2	8 28 4:28 0 28	3 8 3 5 3 1	7,28 3,28 9,28	35 51 17	,28 128 28	82 45	28 28 28	47 47	-28 128 228	79 45 12	(28) (28) (28)	4
1.6	1.32	61,30 28,29 36,29 63,29 30,27	9 6	7 29 3 28 0 29	39	2 27 9 27 9 27	-6: 3:	8/27 5/27 2/36	66 2'	0 27 27 4:26	. 39 0: 1. 7:	9127 5126 2126	73 59 56	0121 6121 3121	72 6.9 65	5 2; 2 2 9 2	7 2 3.8 5 5	2°2' 1912 162	72 68 65	0121 7121 4121	71 68 65	8 27 5 27 2 26	16 83 50	:27 :26 :25	9	127 . 25 326	of 4	527 526 726	1 k 7,5 45	. 21 926 926	-,
f .F	¥430 57′30	97/20 63/2 30/2 95/2 61/2	3 0 7 6 7 3	0127 7126	7,0	6126 3126 6129	5.3 5.6	3(25 0:25 3:21	5.9 5.6	6/25 3/25 1-25	5.4	4 2 2 2 0 2	5 6 5 3 5 0	612 312 312	5 6 5 2	312 1912 1712	5.3 5.3 4.3	8:2 26:2 34:2	5 5 5 2 4 9	612 112 1212	5 5 5 2 4 9	5 25 3 2 5	5 2 8	425 125 324	5	1725 9425 7124	4	9:25 T-25 F-2 :) 32 5. [5 1 %-	425 425 424	1
	71,29 72,28	272 920 572 222 862	6 3 6 (:012 -112 -12	5 4	: 2 92 52	5 7 4 3 5 6	12. 92.	4 3 4 0 3 7	512 312	4 1 3 8 3 4	512 312 212	4 (3 7 3 3)නිය 75[2 යෝද	3.1 3.1)22 712 402	3.: 3 3	99°2 68}2 30°2	3 : 3 : 3 :	9312 5712 1612	3 9 3 6	16C 55Z 14D	3 9 3 5 3 3	: (2. 4/2. 3/2:	3 9 3 2 3 3	1.2	3 2	. (2. 4 • 2. 10/2	3 ± 3 ± 3 ± 3 ±	(1123 (123 (123	

TABLA - 5.8 Tabla para el calculo del porcentaje de elementos defectuosos del lote usando el método de la desviación estándar (Continuación)

Q.												<u> </u>		Ta	m	เก้อ	de	:1 1	ote												
Q		3	4	: }	5		7		16)	1	5 !	20		2	5	3	0	3	5	41	0	50	0	ĩ	5	10	0	15	0	300
.7	6/27 7.26 8.26	. 13 77 5.39	24 24 24	671 331 001	23 23 2 3	7942 472 152	22	122 812 502	22. 22. 22.	79 45 18	22 22 21.	60 2 30 2 99 2	22. 22. 21.	52 22 92	22 22 21	48 18 89	22 22. 21	46 16 86	22 22 21	44 14 85	22 22 21	43 13 84	22 22 21	12: 12: 82	22. 22 21	40i 10i 80i	22. 22 21	3912 0912 7912	22 22 21	38 2 08 3 78 2	2 67 2 67 2 6 1 8 1 -4
	11 _: 25 12:24 13:24	. 25 . 86 . 47	23. 22. 22.	67 33	22 21 21.	192 372 562	21 21	587 277 971	21. 20 20	27 98 68	2 1 20 20	10/2 81/2 52/2	20	75 46	21 20. 20.	00 71 42	20 20 20	98 69 40	20 20 20	97 68 39	20 20 20	96 67 38	20 20. 20.	94 65 37	20 20. 20.	93 64 35	20 20 20	92½ 63½ 35½	20 20 20	91/2 62/2 34/2	1 23 10 41 10 7 10 7
8	16123 17122 18122	2 84. 2 62'	21. 21. 20.	.33: .00: .67!	20 20. 20	62:2 31 1 00:1	9.	07' 78. 48	19 19 19	81 52 23	19 19 19	663 381 101	9	60 32 04	19 19 19	57 30 02	19 19 19	56 28 00	19 19 18	54 27 99	19 19.	54 26 98	19 19. 18	53 25 09	19 19 18	51 24 96	19 19	51 23 96	19 19 tsi	501 221 051	9 = 1
9	1 21 2 20 3 20	. 11j). 66	19 19 19	57) 33) 00)	19 18. 18	07:1 77:1 46:1	3 :	61 1 33 1 04 1	18. 18 17	39 11 84	18 18 17	27 1 00 1 73 1	8 7 7	22] 95] 69	18 17 17	20 94 67	18 17 17	19 92 66	18. 17. 17	. 18 92 65	18. 17	.178 91: 658	18 17 17	175 908 64	18 17 17	16 89	18 17	15) 891 631	18	151 881 621	~ :
999	6 18 7 18 8.17	25 75 75 74 74	18. 17. 17.	67 33	17 17 16	56H 25H 96H	7 6	20) 92) 65	[7. [6. [5	93 76) 4 9l	16. 16 16.	94-1 68-1 42-1	6 6.	91i 654 394	16 16 16	63 38	16 16	38 63 37	16 16	88 62 37	16 16 16	87) 62) 37	16 16	97) 61 36	16 16	56 61 36	16 16	86. 61, 36.	16 16	%61 60-1 36-1	6 ~ 6 %
jξ 6 Ιτ.ο	/1 16 '2 15 3 14	53 53 192	16 16 15	33 00 57	15	07() 73.) 481	5	831. 561 301	15. 15 15.	725 464 215	15 15. 15	66 41	15. 15. 15	.54j .40l .15i	15 15 15	63 39 15	15	63 39	15 15	63 39	(15 15	63 39	15	638 38	15	.62 38 15	15	62 38 15	15 15	62. 381	5 / .3 .5 / .5 /
1.0	1612 1712 1811	2.98 2.27	14	57	14 14 14	62]] 33[] 05[]	[4 [4	51 25 00	14 14 13	46; 22, 97	14. 14 13	44 20 97	l4 !4 13.	44 20 57	14 14 13	44 21 98	14 14 13	44 21 91	14	#4 21 98	14	44 21 99	14 14 13	45 33 99	14 14 13	.45 32 99	14	45 22 00	14 14 14	45-1 22 : 60:	4 0
	12 7 12 7	34 3 39 3 80 5 60 5 08	13. 12 12	انان . 27 33	13 12 12	20 I 93 I 65	13 13 12	25 ルガ 75	13. 13 12	60. 201 108	13 13 12	28f 05 835	13 13 12	29/ 07/ 85	13	30 08 86	13 113 112	31 09 37	13 13	3. 19 88	:13 413 412	32 13 89	113 13 12	32 11 .99	13 13 12	30	λ13 Σ13 Σ12	34 12 91	13 13 12	74 : 12 : 91	i.) U
1 - 1	5- (3, 1 8' s	00 6 00 (Uni (:11. 11 10	.33. :00: 67		.83 56 29	12. 11 11	03 74 56	12 11. 11	12 90 58	12 11 11	1의 2년 75	12 12 11	31 36 7	12 12 11	02 62 81	12	24 03 33	'12 : 12 : 11	.04 .04	#12 F12 F11	25 g= 54	12 12 11	25.	112 113 111	2:	412 711 711	25 25	12 12 11	57 57 57	.2 * .2 * .2 *

TABLA - 5.9 Table para el cálculo del porcentaje de elementos defectueses del lote usando el método de la desviación estándar (Continuación)

श्रम श्रम			_	_									_				Гa	ma	ñ	0 0	iel	lo	ie														_
Qσ		3		4	1	-	5	-	7	? .		10		15	.	20)	2	25		30		35	5	4	0	-	50		75	1	100) [15	0	20	<u> </u>
1.2	2 1	0 1		9 9	6; 3;	7]1 3]1	0.5	50 23 23	10. 10.	. 81 . 63	7]11 5:10) . E	1311 3211	1. 0	134 93 73	11. 10.	98 98		0		l.	22 03 84	11.	24 04 85	11	.05 .05	11 11 110	0	7111 8110	1.0	71: 81: 91: 01:	1.6	09 91	ii 10.	10 91	11. 10.	.11 .92
2	6	0. 0	00 00	8	.დ .გ	9 7	9 8-	21 96	9	.7 .5.	7 1 5	0.(9.5	30. 31	₽. 9.	15i 96i	10.	.02) ((의)이 (의	0. 0.	09 00	10.	. 10 92	10	11	210).]	310) i	221 341 161 38 30	9	17	10. 10. 10	81.	10 10	. 01 . 01
1 3	2	ō ō	00 00	5	.0	3	7. 7.	97 73	8	. 5	2	9 8	03 85	9.	22 04	9	11)).: }.: }	34 17	9.	ა. 20 ივ	9	.23	2 0	1.2	4 9	9.2	6	9.1	55 45 2 2 15	9	30	9.	.31 .15	9	.32
1 3	36	0.	00	4	1.8	3	6.	79 56	7	. 5	3	8.	12 95	8.	. 35	8	. 2	30	8. 8.	33	8	37	8	3	9 8	3 1	I	8 : 8 :	14 14 28	8	79 63 47 31 16	38	49	8	. 5(3:	3 8	.5
1.4	411	0	00	3	3 (XX	5	56	3 6	5 8	30	7.	27	: 7	53	7	- 5	44	ï	70	1	19	1		<u>.</u>	4 - 1	3.	4 :	521	7.	011 86 56 42	7	- 01 73	1 7	7	ر الح 1 الح	7.7
1	47)	Ð	O.	ii.	1	úΟ	4	3	9 :	Ž.		0	. 3.	40	- O-	ا اد). :	JI	2	50	Ìě	7	3 6	ζ.	***	š	74	6	22	6	28 14 00 86 73	- 6	88	3 6	7 1 7 0 5 9	8) 	7 3 7 0 6 9
1	50 51 52 53 54	0 0 0	04 (4 04 1 12	33000	0000	00 00 00 00 00	33333	8 6 4 2 3 0	· 67-88-35	5. 5. 4. 4.	28 13 97 82 67	55555	87 73 59 41 3	166551	2 5 9 5 8 6	0 6 3 0 7	6 . 6 . 5 .	34 20 07 94 81	66665	11 25 15 02	5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	5 4 5 2 5 2 5 9	10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	5.5 6 5 5 5	50 36: 23: 11: 98:	9 9 9 9 9 9	(함 2명 2명 13 (대	9,99000	55, 42' 29 1" 04	56666	50 47 34 21 09	16	6 6: 5 4: 5 2: 5 1	20,6	6636 6636	54 51 28 25 13	56663
1	55		0	c	0	Ωij,	13	2.8	37	4	52	3	1	3	5.5	4	5.	69	5	7	- - -	3 8	2	5	86 ~1	5	88 26	5	.92 (8	5	97 85 73 55 57		5 9 5 8	9	6 i 5 : 5 :	01 39 78 66 54	5
1	62	2 () (i N	0	.UC) N	1.3	72	3	.57	1	3	0	4 (59	4	86	2	1 9	Si	5.1) į (5	04	5	(17	5	l.l.		5 3 5 2 5 0 5 0	5¦ 6†	5 : 5 (19) 08)	5	24	5. 5

TABLA - 5.10 Tabla para el cálculo del porcentaje de elementos defectuosos del jote usando el metodo de la desviación estándar (Continuación)

Q_L			, - ,				T	amaño	o del	lote					
or Q _U	3	4	5	7	10	15	20	25	30	35	40 50	_ [100	150	200
1.66 1.67	0 00	0.00	1.15 1.02 0.89	3.07 2.95 2.84	3 84 3 73 3 62	4.25 4.15 4.05	4 43 4.32 4 22	4 52 4 4.42 4 32	4.58 4.48 4.38	4 62 4.52 4.42	4.75 4. 4.65 4. 4.55 4 4 45 4. 4 35 4	69 4.74 59 4 64 49 4 55	4 77 4 67 4 57	4 80 4 70 4 .60	4.81 4.71 4.61
1.71	0.06	0 00	0.55	2 51	3 31	3 75 3 65	3 93	4.02 3.93	4 09	4.13	4 25 4 4.16 4. 4.07 4. 3.98 4 3.89 3	20 4.2 0 11 4-17	4 29 4 4 19	4 31	4 23
1.77 I 78	0 00	0 00	0.060	$\frac{1.92}{1.83}$	2 74	3 20	3.38	3 40	3.55	3 59	3 53 3	76 3.81 67 3.71 59 3.64	1 3 84 3 76 1 3 67	3 87 3 78 3 70	3 88 3 80 3.71
1 81 1 82 1 83	0 00	0.00	90 0 90 0 90 0	1 57 1 49 1 41	2 40	2 36	3.05 2.98	3 16 3 08	3.22	3.27	3 38 3 3.30 3 3.22 3 3.15 3 3.07 3	35 3.40 27 3.30	0 3 43 3 3 36	'3 46i :3 3di	ارته د کرانۍ
65 87 88 89 89	0 60 0 60 0 60 0 144 0 140 0 140 0 140	0 30 0 00 0 00 0 50 0 00	0 (40 0 (40 0 (0) 0 (0) 0 (0)	1 26 1 15 1 12 1 16 0 59	2 09 2 02 1 95 1 88 1 81	2 56 2 48 2 41 2 31 2 28	2 75 2 68 2 61 2 54 2 47	2 35 2 78 2 71 2 54 1 2 57	2.92 2.85 2.78 2.71 2.64	2.97 2.89 2.82 2.75 2.69	3 09 3 2 93 2 2 86 2 2 79 2 2 72 2	05 3 19 97 3 6. 90 2 9 83 2 8 77 2 8	74 3 13 34 5 06 51 2 34 31 2 35 31 2 35	3 16 3,09 3 62 2 33 2 33	ري (م) (م) (مو) (مو)
											2 65 2 2 54 2 2 52 2 2 46 2 2 40 2				
-1 am	11/16	23 43	13 %	(1) - e.	. 1 22	1 7 K	' 1 4	" 2 63	ዞ ? ነታ	2 10	: 2 .7 2	39 2 4 3 2 3 27 2 2 2. 2 2 15 2 2	3 2 7 7 2 7	: 203	53 4 : 4 : 4 : 4 :
2 % 2 %	-(-(g -5-(0 -0-(0	(0 m) (0 m) (0 m)	0 ∪0 0 ∪0 0 00 0'	11 3- 11 3- 12 32	1 12	5. 1 47	1 7e 1 71 1 66	9-1-50 1-21	i i yi	1 4	2 05 2 1 2 1 3 1 1 55 2 1 1 55 1	*5 2 1 *4 2 0	1 2 14 6 2 15 1 2 14	2222	1.
មិន មាន	3 90 3 90 3 90	(1) (c) (1) (n) (1) (c)	- ⊕ (k) - 0 (%) - (,770	(0 <u>2</u> . (1 5)		(1 33 , 1 28 , 1 11	1 57 1 47 1 1 43	l' 1 61 7 1 57 2 1 51	11 64 5 1 60 2 1 50	1 1 72	1 50 1 2 1 76 1 9 1 73 1 3 1 50 1	76 1 5 71 1 7			-,-

TABLA - 5.11 Tabla para el cálculo del porcentaje de elementos defectuosos del lote usando el método de la desviacion estándar (Continuacion)

Q _L							Ta	maño	del k	ote						
Qσ	3	4	5	1 7	10	15	20	25	30	35	40	50	75	100	150	200
120	0.00	0.00	0 00	0.10	0.74 0.71 0.67 0.61	1.08	1.26	1.39	1.42	1 46	1.49	1.58	1.59	1.66	1 69 1 55	1.70
160	0 00 0 0 00	10.00 In no	00.0	i0.05	0.58 0.55 0.52 0.49 0.46	0.93	1.10	1.20	1.26		.34	1.38	1 43	1.46	1 49	1.50
.22(0.000 0.000	0.000	0.000	(0.00 (0.00)	50.437 00.413 50.389 30.366 20.345	0.772 0.743 0.715	0.936 0.905 0.875	0 996 0 965	1.087	1.128 1.095 1.063	1.158 1.125 1.003	1 199 1 166 1 134	1.253	1.279	1 305	1.2
27(3.000 3.000 3.000	0.000	0.000	70 00 100 00 100 00	1 0 324 0 0 304 0 0 285 0 0 267 0 0 250	0.534 0.509 0.585	0.762 0.762	0 876 0.848 M 821	0.933 0.904 0.876	0.972) 0.943) 0.915)	972	1.041 1.011 1.022	1.092	1.117	1.142	1.1
.32 (000 000 000 000	0.000	0.000	70.000 X0.000 X0.000	00.233 00.218 00.203 00.189 00.175	0.516 0.495 0.474	0.661 0.637 0.614	0.743 0.719 0.695	0 797 0.772 0 748	0 834 6 0 809 6 0 7844).862)).8363	0.900 0.874 0.848	0 949 0 923	0.974	0 997 0 971	0 9
.35 (.37 (.38 () 000).000).000	(0.000 (0.000 (0.000	(0,000 (0,000 (0,000) (0.00) (0.00) (0.00)	0.163 00.151 00.139 00.128 00.118	0 416 0.398 0 381	0 550 0 530 0 510	0.628 0.605 0.586	0.678 0.656 0.635	0.714) 0.691 0.670	0.740 0.717 0.695	776 753	0 823 0 799	0 846 0 822	0.545 0.545	0.8
42(43(3.000 3.000 3.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000) 0 004 0 0 004 0 0 004	00 109 00 100 00 091 00 083 00 076	0 332 0 317 0 302	0.455 9.437 0.421	0 527 0.509 0 491	10.575 ,0.555 10.537	0 6086 0 5886 0 5696	0 633, 0 613 n 503	0.667 0.646 0.627	0 711 0 691 0 620	0 733 0 712	0 53 0 34	0.7
47 (48 (J.000 J.000 J.000	0 000 0 000 0 000	0 000 0 000 0 000	70 00 10,00 10 00	00 069 00 063 00 057 00 051 00 046	0 252 0 249 0 237	0 373 0 339 0 344	0 440 0 425 0 409	0 484 0 468 0 452	0 516k 0 499k 0 482k	0 5395 0 521; 0 5055	0 571 0 553 0 536	0 613 0 595 0 572	10 634 10 615 10 597	0 <4 0 <35 0 <35	0.6
.52(.53(0 000 0 000	(0 000 (0 000 (0 000	0.000)10.00 10.00 10.00	00 041 00 037 00 033 00 029 00 026	0 204 0.193 0 184	0 304 0 292 0 280	0.366 0.352 0.339	0.407 0.392 0.379	0 4369 0 4219 0 4079	0 457; 0 442 0 429	0 487 0 472 0 457	0.527 0.511 0.49	10.546 10.530 10.514	10 563 10 549	\$0.5 \$0.5 80.5

100

TABLA - 5.12 Table para el cálculo del porcentaje de elementos defectuosos del lote usando el método de la desviación estándar (Continuación)

Q _L							Ta	maño	del l	ote						
Qσ	3	4	5	7	10	15	20	25	30	35	40	50	75	100	150	200
2.12(2.13(0.00	00.00 00.00 00.00 00.00	0.00	0.12 0.10 0.08	0.71 0.67 0.64	1.12 1.08 1.04	1.30 1.26 1.22	1.39 1.35 1.31	1.46 1.42 1.38	1.50	1.53	1.58	1.63	1 66 1 62 1.58	1 65 1 51	1 75 1 70 1 66 1 62 1 58
.17	0.00	0.00 00.00 00.00 00.00	0.00	0.04 0.03	0.55 0.52 0.49	0.93 0.90 0.87	1.10 1.07 1.03	1.20	1.26	1.30	1.34	1.38	1.40	1.46	1 49	1.50
.22 (0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.006 0.003 0.002	0.389 0.366 0.345	0.743 0.743 0.715 0.687	0.936 0.905 0.875 0.845	0.996 0.965 0.935	1.087 1.054 1.023 0.992	1 128 1.095 1.063 1.032	1.158 1.125 1.093 1.061	1.199 1.166 1.134 1.102	1.253 1.219 1.186 1.154	1 279 1.245 1.212 1 180	1 305 1 271 1 238 1 205	1.318 1.283 1.250 1.218
.27	0.000 0.000 0.000	000.00 000.00 000.0 000.0 000.0	0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.285 0.285	0.609 0.535	0.789 0.762 0.735	0.848 0.848 0.821	0.933 0.904 0.875	0 972 0.943 0 915	0.972	1.041	1.092 1.062	1.117	1 142	1.124
.32(000 000 000	0 000 0 000 0 000 0 000	0.000	0.000	0.218 0.203 0.189	0 516 0 495 0 474	0.551; 0.637; 0.614	0.743 0.719 0.695	0.797 0.77 2 0.749	0.834 0.809	0 862 0 836	0.900 0.874	0.949 0.923	0 974 0 947	0 997 0 971	1.009 0.982
.350 .37(0	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000 0.000	0 000 0 000 0 000	0.139 0.139 0.128	0 415 0.398 0 381	0.530 0.530 0.510	0 628 0 606 0 586	0 678 0 656 0 635	0 714 0 691 0 670	10 740 -0 717 10 695	0 776 0 753 0 730	0 823 0.799 0 777	0 846 0 822	0 569 0 545	0 880 0 856
42.0 42.0	0.000 0.000 0.000	000.00 000.00 000 0 000.0	0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.091 0.083	0.332 0.317, 0.302	0.455 0.437 0.421	0.527 0.509 0.491	0.575 0.555 0.537	0.608 0.588 0.589	0 633 0 613 0 593	0 667 0 646 0 627	0 711 0 691 0 670	0.733 0.712 0.692	0.755	0.74
46) 47(48)	0.000 0.000 0.000	000.0 000.0 000.0 000.0	9.000 9.000 9.000	0.000 0.000	0 053 0 057 0 051	0 262 0 249 0 237	0 373 0 339 0 344	0 440 0.425 6 409	0 484 0 468 0 452	0 516 0.499	10 539 10 521 10 505	0 571' 0 553' 0 526'	0 613 0 595 0 577	0 634 0 615	0 *34 0 633	0 66 0 648
51,0 .52,0 .53,6	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	9 000 000 0, 000 0	090 01 000 01 000 0.	0 037 0 033 5 029	0 204 0 193 0 184	0 304 0 292 0 290	10 356 10 352 10 339	0.407 0.392 0.379	10.436 10.421 10.401	約.457 約.442 約.428	(0 487) (0 472) 8. 457	0.527 0.511 0.495	10 549 10 530 10 514	10 565 10 549 30 533	#0 575 #0 554

FABLA - 5.13 Tabla para el cálculo del porcentaje de elementos defectuosos del lote usando el metodo de la desviación estándar (Continuación)

81										Tai	mañ	io de	el lo	te									
Qu	3	4	-	5	7	1	10	15		20	25	.] 3	30	35		4ባ	50		75 .	100	15	0 , 2	00
3 000 3.010 3.020 3.030 3.040	000 C	40 000 40 000 40 000)(C	000 000	0 00 0.00 0.00	0600 0000 00010	000 000	0 00 0 00 0 00	60 50	.024 .022	0.0	40 0 38 0 36 0	052K 050K 018K) 06) 05) 05	20 90. 70	070 067 064	0,01 0,01 10,01	31 0 78 0 75.0	097 (093k) 090k	3 105 3 101 3 098	$0.1 \\ 0.1 \\ 0.1$	14.6 166 060	.18 [14] [10]
3 054 3.064 3 07 3.084 3.094	0000,0 0000,0 000	100 OK 100.00 100.00 100.00	연 연이. 사이	000	0,0 0,0 0,0	00/0 00/0 00/0	000 000. 000	0 00 0 00 0 00	30 30 30	.017 .016 .015	0.0	300. 290 270	039 037	0.0: 0.0: 0.0:	170 170	.056 .054 .052	0.0 0.0 0.0	64 0 64 0 61 0	0808 0779 0748	0.084 0.084 0.08	50 0 50 0 10 0	1950 1926 18910	096 096 092
3.10 3.11 3.12 3.13 3.13	0.000 0.000 0.000	60 66 00.00 00.00	않0. GO 하	000. 000	0,0 0,0 0,0	00(0 0000 0001	999. 999. 999.	0.00 00.00 10.00)2 0)2 0)2 0	1.012 1.011 1.011	0 00 0,0 0 6	123 0. 122 0. 121 0	.032 .031 .029	0.00 0.00 0.00	390 380 360	.045 .043 .041	0.0	15410 152 0 150 0	:066; :064 :061;	0.07 0.07 0.08	320 C 010 C 010 C	2804U 2774+ 244++	080 080 0771
3.16	000 004 000 004 000 004	00 00 00.00 00.00 00.00 00.00	olo solo solo	000 000	40 0 40 0 40 0	00000 00000 00000	000	00 00 00 00 01 01	01 0 01 0 01 0	900 900,008 900,00	910.0 810.0 710.0	017 0 016 0 0150	025 024 022	000	3110 3010 2810	036	90 0 90 0 90 0)44(0)42(0)40(0	053 053 050	10 06 10 05 10 05	0∜0 (8∤0 (640 (36644 3644 5624	069 967 065
3 21 3 22	0.00	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	040K 040K 040K	000 000	0.0K 0.0K 0.0K)(00x)(00x)000,0)00 ()00 (30 0 30 0 30 0	00'(00() 00()	0 00: 0 00: 0 00:	610.0 510.0 510.0	313 0 512 0 511.0	019 018 017	10 0 30 0 15 0	124KU 123 C 122KU	020	#U 1 710 (510 ()334k 334k 332k) 043) 043) 041	10 0: 10 0: 10 0:	1960 - 1860 -	053₁) 053₁) 05+≠	056; (54)
3.26	90,00 10,00	00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 V	000	000 000 000	OOOK OOOK OOOK	5 00 5 00 3 00	010 0 010 0 010 0	1001 1001 1001	0 00 0 00 0 00	4¦0 : 440 : i⊗n :	009 <u> </u> 0 009 0 008 0) 013) 013	60 6 \$6.0 86.0	л94)19∢ н7а) (2) (2) (2	30 20 30	0254 0254 0264	0,037 0-035 0-03:	no o ilo o ilo o	11 U 10 0. 38 0	1145 1044 1042	, ખક્ક ખક્ક બક્ક
3.31	10 00 30 00 30 00	10,810K NJ. 010K NJ. 010K NJ. 010K NJ. 010K	00:0 (+7:0 n:5:0	000 000 000	0,0 0,0 0,0	000) 000)	0 00 0 00 0 GO	0,0 1 0,0 0 6,0 0	700° 700° 110°	AC 00 O∪ 00 OO 00)2:0)2:0)2:0	60740 00610 00610) () () () () () () () ()	1i0 0:0 0:0	1154 014 213	0 61 0 61 0 61	-880 -7:0 -541	(20) (20) (21)	0 934 0 021 0 021	900 900 200	3410. 3210 31/0	.036 .035 .037	042 040 1039 137 136
i3 36 2 37 2 8	60 00 70 00 71 010	 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	000 000 000	00 00,00 00,0	0:0 0:0 nn	900 900	0 00 0 00 0 00) 04X (0.0X (04X	900 900 100	10 04 10 04 10 0	6 210 0210 01-0	0054 (2051 3010	0-06 (1-55 (1-55)	왕() 동() 라()	011 011 (40	9 0 0 0 0 0	(40 130 130	918 915 C16	10 12 10 12 50 12	1490-1 1310-1 1210-1	250 250 250	1135. 10 kg 10 <u>2</u> 61	033
3 42	10 00 20 00 30 00	00/0 in 00/0 0 00/0 0 00/0 0	500K 500K 500K	0 00 0 00 n no	0-00 10-00 10-00	(66) 000 000	£0.00 ∤0.04 H0.04	X640 ± ⊁⊬0 ± Xu0	900 300 307	MO 04 ZO 0 ZO 0	619 619 619	±003; ±003; €003;	0 14. 13. E. 13. E.	1610 1640 1540	999 (K.8	10 0 10 0 10 0	1.46 100 106	013 514 613	65 02 FU 51 20 01	(6) (50) (80)	1220 1200 13.0	1 025 1 025 1 024	029 027 026 025 025

TABLA - 5.14 Tabla para el cálculo del porcentaje de elementos defectuosos del lote usando el método de la desviación estandar (Continuación)

Q_L									Fam	año	đei	lot	ε									
Qu	3	4	5		7	10	15	2	o į	25	30)	35	4	0	50	7: i	5	100	130) 3	:00
3.000 3.010 3.020 3.030 3.040	000.0 000 (0 000 0 000 0 000	0 0k 0 0k	00 0 00 0 00:0	9000	000 000 000	(0 00) (0 00) (0 00)	50.0 50.0)240)220)210	.040 .038 .036	0 0 0,0 0 0	52 0 50 0 48 0	.062 .059 .057	0 0	070 0 067 0 064 0	081 078 075	10 0 10 0 10 0)97 0)93 0)90 0	105 101 098	(0 1) (0 1) (0 1)	(4 ¹ 0 (6 ¹ 0 (6 1 0	118
3.060 3.070 3.086	000 000 000	0 00X (0.00X (0.00X (0.00X (0.00X	0 0k 0.0k 0 0k	00 0 00 0 00 0	9000. 9000. 6000	000 0 000,0 000 0	60 00:	310.0 310.0 310.0)17()16()15(030 029 027	0.0 0.0 0.0	14 I (0 139 0 137 (0	050 047 045	0.	056 0 054 0 052 0	064 064	0.0 0.0 0.0	380% 377(0 3746	088 085 081	(0.01 (0.01 (0.01	かん. 92つ 890	,099 ,096 ,092
3.11k0 3.12k0 3.13k0 3.14k0	000 0 000 0 000 0 000 0	0.00.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000	0.0k0 0.0k0 0.0k0 0.0k0	0000 0000 0000 0000	000 000 000 000	0 000 0 000 0 000 0 000 0 000	00.00 00.00 00.00 00.00	20. 20. 20. 10	012(0 011) 011) 010)	0.023 0.022 0.021 0.019	30 (0 20 (0 10 (0 10 (0)3210)3110)2910)2810	039 038 036 0.034	0.00.	045(0 043(0 041(0 040(0	1.054 1.052 1.050 1.048	10.1	064) 064) 061 059	073 0 076 0 068 0 068	80.0 0 0 80 0 50 0	80%) 77(0 44(0 71(0	083 080, 077 075
3.16 3.17 3.18 3.19 3.19	0.000 0.000 0.000 0.000	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	00.0 9.00.0 00.00 00.00	0000 0000 0000 0000 0000	000 000 000 000	0 000 0 000 0 000	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	100.	009 008 007 007	0.013 9 016 0 019 0 01	7 0.1 5 0.1 5 0.1	025 024 022 021	0.031 0.030 0.028 0.021	100. 300. 70.	0360 0350 0330 0320	04: 7,042 7,044 7,044 7,032	10000	055k 053k 050k 049k	0 066 0 054 0 056 0 05	360 C 360 C 360 C 410 C	66(1) 64(1) 62(1) (59(1)	069 067 065 063
3.21	00000 00000 00000	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	0 0 (0 0 (0 0 ()000K)00K	000 (000, (Yun (0 00 0 00 0 00	0 0 .00 0 0 .00 00.00	90(0K 20(0K 20(0K	006 005 005	0,01. 0 01: 0 01	3:0 · 2 [:] 0 · 1:0	019년 01원 017년	0 02: 0,02. 0 02:	4 0 3 0 2:0	029 027 026) 03:) 03:) u3:	5i0 4,0 2 ⁱ 0	045 043 041	0 05 0 04 0 04	에O_0 원() (610 ()55/. 63/. 61	/ 05/ / 05/ VS
3 260 2 275 2 285	00.00 00.00 00.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00. 100 100	000k 000k	000,0 000,0 000	90 0k 00.0k 00 0k	010 CK 010 CK	1010 1010 1010 1010	004 004 003	0 00 0 60 10 00	910 1940 1840	015 014 3±3	0 01 0 3. 0 01	90 90 70	023 022 021	0-02 0-02 0-02	50 70 50	037 035 034	10 04 10 04 10 03	10 00 00	045 0444 042:	54 14 5 04
3 31 3 32 3 33	90 00 10 00 10 10	00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	ж-0 ж-0 ж-0	000 000 000	0 000 0 000 0 000	20 0K 20 0K 30 0K	10,0 01 6,0 01 10,0 01 10,0 01	0100 0100 0110	003 002 002	30 06 00 00 30 00)7¦0)6¦0)6⁄0	011 010 616	10 01 10 01 10 01	50 40 30	-018 -017 -015	10 52 10 62 10 G	2010 2210 2110	- 630 629 - 621	10 00 10 00 10 00	3490. 3210 3130	0356 056 035	r 04 r US 05
33 33 33 33 38 39 39	M 00 10 00 10 00 10 00	NO OHON NO OHON NO OHON NO OHON NO OHON	0400 . 0400 . 0400 0400	000 000 000 000	0 000 0 000 0 000 0 000 10 000	010 0K 010 0K 010 0K	, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	0040 00-0 00-0 00-0	002 002 001 001	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	05:0 55:0 04:0 04:0	008 008 00° 00°	80 01 90 01 90 01 90 0	1160 160 160	014 013 013 013 013	10 0 10 0 10 1	180 170 160 160	1 52-) 62-) 62-) 62-	10 0 380 0 210 0 110 6	25,0 26,0 25,0 21,0	031 037 627 023	- 00 - 01 - 01 - 01
3 42	00 00 00 00 00 00 00 00	0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0	90 (0 , 90 (0 , 00an	000 000 000	:0.00 :0.00 :0.00	040 04 010 04 040 04	0 0400 0 0400 0 0400	KOKO KOKO KOKO	: 001 : 001 : 001	10 01 10 01 10 01 10 01	0340 9310 63.6	(904) (95) (95)	90 04 90 06 90 06	794 10.0 10.0) (01. } (31)) (01)	1000 300 350	146 140 437) (2) } (1) } (2)	070 J 940 G 844 G	220 210 210	(25 (25 (25	. D.

1881 A . 3.13 Labla maestra para inspección reducida para planes basados en cariabilidad desconocida (límite de especificación

0.455 0.536 0.611 0.611 0.664 0.695 0.695 0.712 0.723 0.341 0 0 341 0 393 0.774 10.00 × 0.675 0.755 0.828 566 566 617 0.828 0.886 0.917 917 936 946 365 366 366 8.1 8.3 20 Α. ဝဒဲ 000 000 ø 0.874 0.955 1.03 0,765 0,765 0.814 765 1.03 1.09 1.12 1.12 1.14 1.15 \$ 24.2 9 00 ج. 0.958 0.958 0.958 1.01 1.07 1.15 1.23 1.30 1.30 1.33 2.5 2.5 S 388 ٠. 2 simple-forma 1), método de desviación estándur (Tubla B-2 del MIL-STD-414) 22.1 1,12 1.53 1.61 1.50 1.24 1.41 1.47 1.51 × Niveles de calidad aceptables 00 1.40 1.50 1.58 69 72 73 8 4 4 ٠. ج 665 بر. 1,73 1,79 1,82 33,33 $\frac{1.93}{1.98}$ 0.65 1.53 1.62 1.72 1.45 -2 2.08 ---288 1 65 1 75 1 84 ₽ 25.38 ÷ 0 0.25 88 85 85 = ± = 88= 8383 ~ -22 20 20 20 212 0 15 8= 230 ភេនឌ 87 بيد સં જ 24 67 53 200 04.00 0.10 88% 897 38 5 4 લંગ બ 04.04 0 (85 ÷:-17 50 51 £ £ ٠. 24.24 N 20 20 20.00 83 58 61 61 0 04 55 4 010.04 ns ca Limeno de la muestra 2 ~ 0 ನ ನ ೧೯೮ 222 - 223 38 than other del tamaño de la muestra ZZO 20 <u>د</u> ک --

Use et primer fran de muestreo debajo de la Becha, esto es, tanto el tamaño de la muestra como el valor de A. Cuando el tamaño de la muestra es igual o mayor que el tamaño del lote, debe inspeccionarise cada uno de los elementos del lote Lodos pos valores de AQL vienen dados en porcentaje de d'ementos defectuosos.

FRI DE CONTRACTOR DATA MACATTA PARA INSPECCIÓN reducida para planes basados en variabilidad desconocida (limite de especificación doble 3 forma 2), limite de especificación simple (Tabla B-4 del MIL-STD-414)

						······································		
	10.00	М	40.47	40.47 40.47 36.90	33.99 30.50 27.57	27 57 25.61 24 53	24 53 23 97 23 58	22.00 21.11
	6.50	M	33,69 33,69	33.69 33.69 29.45	26.56 23.29 20.74	20 74 18.91 18.03	18.03 17.51 17.24	15 87 15.13
	4.00	Ж	26.94 26.94	26.94 26.94 22.86	20 19 17.35 15.17	15.17 13.71 12.99	12 99 12 57 12 36	11.23
	2.50	M	18.86 18.86	18.86 18.86 16.45	14.39 12.20 10.54	10.54 9.46 8.92	8 92 8.63 8 47	7 61 7.15
	1.50	M	7.59 7.59	7.59 7.59 10.92	9.80 8.40 7.29	7.29 6.56 6.17	6.17 5.97 5.86	5.20
ceptables	1.00	M		5.50	5 83 5.35 4.77	4.77	3.97 3.97 3.91	3.45
Niveles de calidad aceptables	0.65	M		1.53	3,32 3,55 3,26	3,26 3,05 2,95	2 95 2.86 2.83	2.49
Arveles de	0.40	М		>	1.33 2.14 2.17	2.17 2.11 2.05	2 05 2 65 3 65	1 71
Z 4	0.25	M			1.30	1.31	1.29	1.17
	0 15	M			√ 0.422 0.716	0.716 0.818 0.846	0 846 0 877 0 879	0 789
	0.10	M			0.349	0.549	0 551 0 551 0 581	0.503
	0 065	M			1	0.365	0 365 0 380 0 413	0.363 0.330
	0.0	W				0.186	0 228 0 250 9,280	0.250 0.228
	Lamaño de	in more and	ကက	004	5 2 10	10 15 20	26 30	50
-	Letta-codigo de tamaño de la	шиемга	3 0		OH-	 ~×1	CZZ	à 3

Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha, esto es, tanto el tamaño de la muestra como el valor de A. Cuando el tamaño de la muestra es igual o mayor que el famano del lote, debe inspeccionarse cada uno de los elementos del lote Fodos los valores de AQI vienen dados en porcentaje de elementos defectuosos



doble y forma 2), lindte de expecificación simple (Tabla 11-4 del AHL-STD-414) Tabla macerra para inspección reducida para planes basados en variabilidad desconsser.

	10.00	M	40.47	40.47 40.47 36.96	33.99 30.50 27.57	27.57 25.61 21.53	24 53 23 97 23.58	22.00 21.11
	6.50	W	33.69 33.69	23.69 23.69 29.45	26.56 23.29 20.74	20,74 18,94 18,03	18 03 17 51 17.24	15 87 15 13
	8.4	×	26.94 26.94	26.94 26.94 22.86	20.19 17.35 15.17	15 17 13,71 12,99	12.99 12.57 12.36	11, 23 10,63
	2.50	Ŋζ	18.86 18.86	18.86 18.86 16.45	14.39 12.20 10.54	10 54 9 46 8.92	8 82 8.63 7.47	7 61
	1.50	M	7.59 7.59	7.59 7.59 10.92	9.80 8.40 7.23	7,29 6,56 6,17	6 17 5 97 5 86	5.20 4.87
republes	8.	Ħ		5.50	5.83 5.35 4.77	4.77 4.31 4.09	4 0.00 9.00 9.00	3,45
calidad a	0.65	M		- 53	3.32	3.26 3.05 2.95	2 95 2.86 2.83	2.49
Niveles de calidad aceptables	0.40	¥		·>	1.33 2.17 2.17	2.17 2.11 2.05	2 05 2 05 1.98	1.71
ha	0 25	Ж			30.00	96 - 1 17.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18	1.29 1.29 1.29	1 17
	0.15	M			0.422 0.716	0.716 0.818 0.846	0 846 0 877 0.879	0 789 0 720
	0 10	¥			o o de	0.248 0.503 0.844	0 551 0 551 0.581	0.5u3 0.467
	0.065	M				0 365 0 365	0 365 0 413	0 383
	0 64	M				0.186	0 228	0.750
	Lamitho de			004	5 7 10	20 20	30	50
	s etta coosgo del emano de la	(Burstra	CG	236	0=-		ZZO	40

fodos los valores de AQE senen dados en porcentaje de elementos defectuosos. Use el primer plan de muestros debajo de la flecha, esto es, tanto el tamaño de la muestra como el valor de k. Cuando el tamaño de la muestra es igual o m you que el tamado del fote, debe inspectabarse cada uno de los elementos del fote

TABLA - 5.18 Método de desvizción estándar, valores de 7 para inspección rigurosa (Tabla 8-6 del MIL-STD-414)

Letra-	l				Nive	tes d	e cali	idad	acept	able					Numero de
ගද.දී.	.04	065	.10	15	25	.40	.65	1.0	1.5	2 5	4.0	65	10.0	15.0	lotes
В	*	Ð	23	εķ	*	ů	t	ø	\$	2 4 5	3 5 6	4 6 8	4 7 9	4 8 11	5 10 15
С	*	æ	\$	¢	α	a	¢	2 3 5	2 4 6	3 5 7	3 6 8	4 7 9	4 7 10	4 8 1:	5 10 15
D	•	λī	¢	8	sa.	Ċ	2 4 5	3 4 6	3 5 7	3 6 8	4 6 9	4 7 10	4 8 11	4 3 11	5 10 15
Ε	c	*	4	¢	2 4 5	3 4 6	3 5 δ	3 5 7	4 6 8	4 6 9	4 7 9	7 10	8 11	8 11	5 10 15
F	¢	42	à	3 4 6	3 5 6	3 5 7	3 6 8	6 8	4 6 9	7 9	7 10	8 11	4 8 11	4 8 11	10 15
G	3 4 6	3 5 6	3 5 6	3 5 7	3 6 7	4 6 8	4 6 9	4 7 9	7 9	4 7 10	7 10	\$ 11	8 11	8 11	5 10 15
Н	3 5 6	3 5 7	3 5 7	3 6 8	4 6 %	4 6 9	4 7 9	4 7 9	7 10	4 7 10	8 11	8 11	4 8 11	8 11	5 10 15
1	3 5 7	3 5 7	4 6 8	4 6 8	4 6 9	4 7 9	4 7 9	7 10	4 7 10	7 10		8 11	8 11	4 8 1i	5 10 15
J	3 6 8	4 6 8	6 8	4 6 9	4 7 9	4 7 9	4 7 10	4 7 10	4 7 10	8	8 11	8 11	5 11	4 8 11	5 10 15
К	4 6 8	6 8	; 4 ; 6 ; 9	6 9	7 9	4 7 9	1 4 7	7 10	8 10	8	8 11	4 8 11	8	111	10 15
L	; 5 9	6 9	. 4 . 5 9	7 9	7 9	7 10	7 10	7 10	8 10		. 8		8 11	11 11	
M	5 9	7 9	1 4 7 9	7 9	1 7 10	; 7 ; 10	7 10		4 5 11		9	8	1 8 11	8	10
N	7 9	17.9	4 7 10	1 10	4 7 10	1 4 7 10		11	4 8 11	1 8	111	8	1	3 11	10
0	10	10		4 7 10	4 7 10			8 11	11	3 3	}	3 8 . , 11	1 2	3 8 11	10 11 15
P	4 7 10	10	10	± 8 10	_:	11	8 11	11	3 8 [1]	3 3 L 1	3 8 1 1	3 8 1 13	1	3 8 1 13	10
Q	1 1 2	1 8		8	4 8 11	1 8	કો ક	3 8	3 : 8	3 .	3 3	3 8 1 1	3 3	8 : 3 1 : 12	3 10

^{*} No hay planes de muescoo previstos en este estandar para esas letras-cod go y valores de AOL

Tudos los valores estimados para el pocentaje de elementos defectuosos del jote se obtienen de la Tudia A154 (Tabia B 5 del MIL-STD-414)

La cina de arriba de dada casina corresponde a los o lotes precedentes, la dol medio a los 10 lotes precedentes y la de abajo a los 15 lotes precedentes. Se exige inspection rigurosa cuando la cantidad de lotes con estimados de porcentais de elimentos defectudoses por encima del AQL de los 5, 10 o 15 lotes precedentes es mayor que el salor de Tien la litera y la media del proceso de esos lotes es mayor que el AQL.

	ţ
] B.]	The second secon
Tabla	
(MSD) (
mâxima	
estándar	
desviación	
=	
r para	
ار د	
Valores	

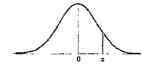
1				1			-		-	,	100000000000000000000000000000000000000			 	
ostipoa-ma l							AQL (p	AQL (porcentaje de elementos delectuosos)	de eteme	ontos acid	company)	1		1	
del tamano le la muestra		0.00	0.005	010	\$1.0	0.25	0+0	0.65	98	1.50	2.50	90.4	6 50	10 00	15.00
99				í		!	!		0.339	0.353	0.436	0.453	0 475	0.502	0.538
) a = =	5 2 2]	:		0.214	0.242	0.253	0.294 0.266 0.248	0 308 0 280 0 261	0.323	0.346 0.318 0.298	0 372 0,345 0,324	0.408	0.425	0.511 0.485 0.460
	385	0.182	0 188 0 183 0 180	0.195	0.202 0.197 0.193	0.206	0 222 0 216 0 212	0.235 0.229 0.225	0.248 0.242 0.238	0.262 0.255 0.251	0 284 0 277 0.273	0.309 0.302 0.297	0.336	0.386	0 442 0.432 0 426
_	25.04	0.173	0.179	0.185	0.192 0.189 0.188	0.201 0.198 0.198	0.210 0.208 0.207	0 223 0 220 0 219	0,236 0,232 0,232	0 249 0 245 0 245	0.270 0.266 0.266	0.295 0.291 0.290	0 328 0 323 0.323	0.364 0.364 0.363	0 423 0 416 0 416
;	50 2 7 7 7 9 100	0 166	0 172 0 168 0 166	0 178 0 174 0.172	0.184	0 194 0 189 0 187	0.199	0.208	0 227 0.223 0 220	0.241	0.261 0.255 0.253	0 284 0 279 0 276	0.317 0.310 0.307	0.356 0.348 0.345	0 408 0 399 0 395
2 2 0	150	0 157	0 163	0.170	0.175	0.183	0 193	0.206	0.216	0 230	0.249	0 269	0.302	0.341	0.386

Areas bajo la curva normai caciónica entra 0 v z

5(XX)

 .4999

5000)



5(XX)

5(11)

		cand	inica en	tra O y 2	Ž.			U Z		
=	6	1	2	3	á	5	6	7	8	9
0.0	0000	0040	.0800	0120	0160	.0199	0239	0279	0319	0359
0.1	0398	()438	0478	.0517	0557	0596	0636	0675	0714	0754
0.2	0793	0832	0871	0910	(? 9 48	0987	1026	1064	1:03	1141
0.3	1179	1217	1255	1293	1331	1368	1406	1443	1480	1517
0.4	1554	1591	1628	.1664	.1700	1736	1772	.1808	(844	.1879
0.5	1915	1950	1985	2019	2054	2088	2123	.2157	2190	2224
0.6	2258	2291	2324	2357	.2389	2422	2454	.2486	2518	2549
0.7	2580	2612	2642	2673	2704	2734	2764	2794	2823	2852
0.8	2881	2910	2939	2967	2996	3023	3051	3078	3106	3133
0.9	.3159	.3186	3212	3238	3264	3289	3315	3340	3365	3389
10	3413	3438	3461	3485	3508	3531	.3554	3577	3599	.3621
11	3643	3665	3686	3708	3729	3749	3770	.3790	3810	3830
1.2	3849	3869	3888	3907	.3925	3944	3962	3980	3997	4015
1.3	4032	4049	4066	4082	4099	4115	.4131	4147	4162	4177
1.4	.4192	4207	4222	.4236	4251	.4265	.4279	4292	4306	4319
15	4332	4345	.4357	4370	4382	4394	4405	4418	4429	4441
16	4452	4463	4474	4484	4495	4505	4515	4525	4535	4545
17	4554	4564	4573	4582	4591	4599	.4608	4616	4625	4633
1.8	4541	4649	.4656	4664	4671	4678	4686	4693	.4699	4706
1.9	4713	4719	4726	4732	4738	4744	4750	4756	4761	4767
2.0	4772	4778	4783	4788	4793	4798	4803	4808	.4812	4X17
2.1	4821	4826	4830	4834	4838	4842	4846	4850	4854	4857
22	4861	4864	4868	4871	4875	4878	4881	4884	4887	4890
23	4893	4896	4898	4901	4904	4906	4909	4911	4913	4916
24	4918	4920	4922	4925	.4927	4929	4931	4932	4934	4936
2.5	4938	4940	4941	4943	4945	4946	.4948	4949	4951	4952
26	4953	4955	.4956	4957	4959	4960	4961	4962	4963	4964
27	4965	4966	.4967	4968	.4969	4970	4971	4972	4973	4974
28	4974	4975	4976	4977	4977	4978	4979	4979	4980	4981
29	4974	4982	4982	.4983	4984	4984	4985	4985	4986	4986
				4988	4988	4989	4989	4989	4990	4990
30	4987	.4987	4987	4988 4991	4988 4992	4992	4992	4992	4993	4993
31	4990	4991	4991	4991 49 9 4	4992	4994	.4994	4995	4993	4995
32	4993	4993 4995	4994 4995	4994 4996	.4994 4996	4996	4994	4995	4995 4996	4997
3.3	4995	4995 4997	.4995 4997	4996 4997	4996 4997	4998	4997	499 0 4997	4990 4997	4998
3 4	4997					F				
35	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	4998	_4998
36	4998	4998	4999	.1909	4999	4999	.4999	4999	4999	4999 4999
3.7	4999	4999	1999	4999	4999	4999	4999	4999	4999	
1.52	4000	2000	4,000	4999	4999	4999	4999	4999	4999	4999